



ARCHIVO DE PRUEBAS OMICRON

AUDITORIA TECNICA DE EQUIPOS DE PROTECCIONES.

PROTECCION 50BF, ASOCIADO AL PAÑO J8 EN S/E PAN DE AZUCAR
MODELO 7SL87, MARCA SIEMENS

INGEMA S. A		CLIENTE	
Probado por: Ing. Mario Aguilar	Revisado por: Ing. Antony Porras	Recibido por:	Aprobado por:
Fecha: 12-04-2019		Fecha:	Fecha:

Equipo en prueba - Ajustes del dispositivo

Subestación/Bahía:

Subestación: PAN DE AZUCAR 220kV
Bahía: J18

Dirección de subestación: COQUIMBO
Dirección de bahía:

Dispositivo:

Nombre/descripción: 50BF_J8
Tipo de dispositivo: 7VK87
No de serie: 7VK87-DAAA-AA0-0AAAA0-
AC0111-12111B-BAA000-
000AA0-CH1BA1-CG0
Info adicional 1: 50BF_PAÑO J8
Info adicional 2:

Fabricante: SIEMENS
Dirección del dispositivo: P1D8321

Hardware

Equipo en prueba

Tipo	No de serie
CMC356	MC355V

Comprobación del hardware

Realizado en	Resultado	Detalles
04-04-2019 10:32:43	Correcta	

-----Group:1. Verificacion Medida Fase L1-----

1.1 Inyeccion 25% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC
Comienzo: 04-abr.-2019 10:37:39
Nombre de usuario:
Compañía:

Versión: 4.00
Fin: 04-abr.-2019 10:38:40
Administrador:

Resultados de la prueba

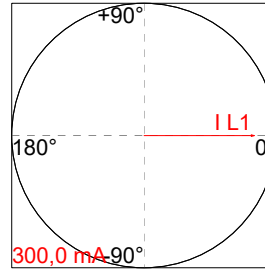
Título: Verificacion de Medida al 25% Fase A

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	500,0 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	0,000 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	0,000 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	500,000A	0,00°
I L2	0,000A	-120,00°
I L3	0,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
Entr.bin 6	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

1.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 11:55:51 Fin: 04-abr.-2019 11:56:04
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

Resultados de la prueba

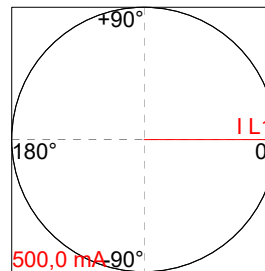
Título: Verificacion de Medida Fase A al 50%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	1,000 kA	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	0,000 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	0,000 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	1000,000A	0,00°
I L2	0,000A	-120,00°
I L3	0,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

1.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 11:56:11 Fin: 04-abr.-2019 11:56:24
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

Resultados de la prueba

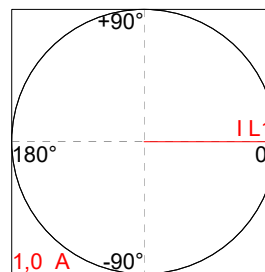
Título: Verificacion Medida Fase A al 100%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	2,000 kA	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	0,000 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	0,000 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	2000,000A	0,00°
I L2	0,000A	-120,00°
I L3	0,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

Group end:1. Verificacion Medida Fase L1

Group:2. Verificacion Medida Fase L2

2.1 Inyeccion 25% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Versión: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 10:39:23 Fin: 04-abr.-2019 10:41:20
Nombre de usuario: Administrador:
Compañía:

Resultados de la prueba

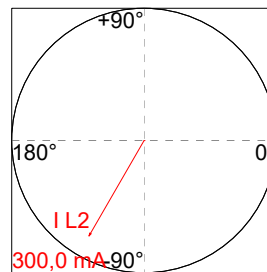
Título: Verificacion de Medida Fase B al 25%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	0,000 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	500,0 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	0,000 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	0,000A	0,00°
I L2	500,000A	-120,00°
I L3	0,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
Entr.bin 6	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

2.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Versión: 4.00
Comienzo: 04-abr.-2019 11:56:32 Fin: 04-abr.-2019 11:56:42
Nombre de usuario: Administrador:
Compañía:

Resultados de la prueba

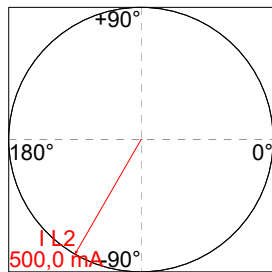
Título: Verificación de Medida Fase B al 50%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son secundarios)			
Directo	I L1	0,000 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	500,0 mA	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	0,000 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	0,000A	0,00°
I L2	0,500A	-120,00°
I L3	0,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

2.3 Inyección 100% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre:	OMICRON QuickCMC	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 11:56:49	Fin:	04-abr.-2019 11:57:05
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

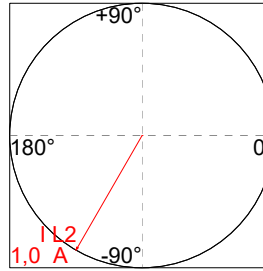
Título: Verificación de Medida Fase B al 100%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	0,000 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	2,000 kA	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	0,000 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	0,000A	0,00°
I L2	2000,000A	-120,00°
I L3	0,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto
Prueba correcta

-----Group end:2. Verificacion Medida Fase L2-----

-----Group:3. Verificacion Medida Fase L3-----

3.1 Inyeccion 25% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre:	OMICRON QuickCMC	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 10:42:00	Fin:	04-abr.-2019 10:42:05
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

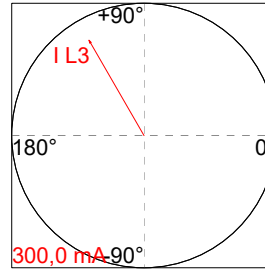
Título: Verificacion de Medida Fase C al 25%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	0,000 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	0,000 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	500,0 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	0,000A	0,00°
I L2	0,000A	-120,00°
I L3	500,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
Entr.bin 6	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

3.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre:	OMICRON QuickCMC	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 11:57:13	Fin:	04-abr.-2019 11:57:26
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

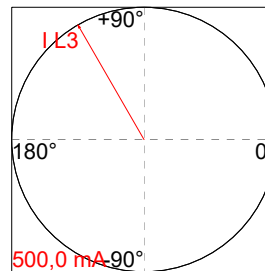
Título: Verificacion Medida Fase C al 50%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	0,000 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	0,000 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	1,000 kA	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	0,000A	0,00°
I L2	0,000A	-120,00°
I L3	1000,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

3.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre:	OMICRON QuickCMC	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 11:57:34	Fin:	04-abr.-2019 11:57:57
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

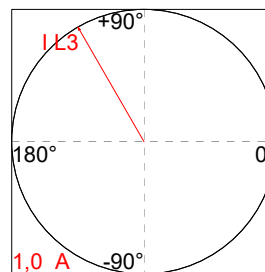
Título: Verificacion Msedida Fase C al 100%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	0,000 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	0,000 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	2,000 kA	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	0,000A	0,00°
I L2	0,000A	-120,00°
I L3	2000,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

----- Group end:3. Verificacion Medida Fase L3-----

----- Group:4. Verificacion Medida Fases L123-----

4.1 Inyeccion 25% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre:	OMICRON QuickCMC	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 10:42:17	Fin:	04-abr.-2019 10:43:17
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

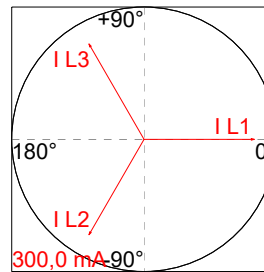
Título: Verificacion Medida Fases ABC al 25%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	500,0 A	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	500,0 A	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	500,0 A	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	500,000A	0,00°
I L2	500,000A	-120,00°
I L3	500,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
Entr.bin 6	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

4.2 Inyeccion 50% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre:	OMICRON QuickCMC	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 11:58:06	Fin:	04-abr.-2019 11:58:31
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

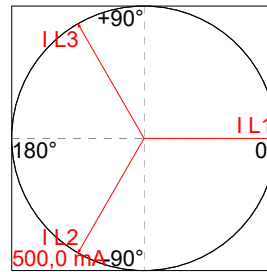
Título: Verificacion Medida Fases ABC al 50%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	1,000 kA	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	1,000 kA	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	1,000 kA	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	1000,000A	0,00°
I L2	1000,000A	-120,00°
I L3	1000,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto

Prueba correcta

4.3 Inyeccion 100% de Inominal:

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON QuickCMC Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 11:58:39 Fin: 04-abr.-2019 11:59:26
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

Resultados de la prueba

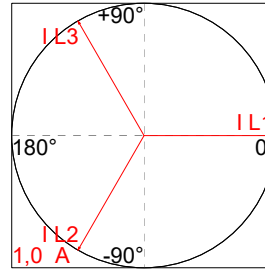
Título: Verifiacion Medida Fases ABC al 100%

Cálculo de falta:

Modo de entrada en tabla	Parámetros (Todos los valores son primarios)			
Directo	I L1	2,000 kA	0,00 °	50,000 Hz
	I L2	2,000 kA	-120,00 °	50,000 Hz
	I L3	2,000 kA	120,00 °	50,000 Hz

Ajustes del generador

I L1	2000,000A	0,00°
I L2	2000,000A	-120,00°
I L3	2000,000A	120,00°



Entradas binarias

Nombre	Pendiente	Tiempo
DISP. L1_52J8	0	
DISP. L2_52J8	0	
DISP.L3_52J8	0	
ENVIO DDT	0	
DISP A 87B	0	
DISP. L1_52J8 BOB2	0	
Sobrecarga	0	

Resumen

1 pruebas correctas, 0 pruebas incorrectas, 0 pruebas no evaluadas 100,00% correcto
Prueba correcta

-----Group end:4. Verificacion Medida Fases L123-----

-----Group:5. Verificacion Pickup 50BF Fase L1-----

5.1 Pickup con Arranque Fase L1:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de rampa: 1
 Pasos totales por prueba: 26
 Tiempo total por prueba: 7,800 s
 Nº de ejecuciones de prueba: 1
 Modo de entrada: Directo
 Tipo de falta:

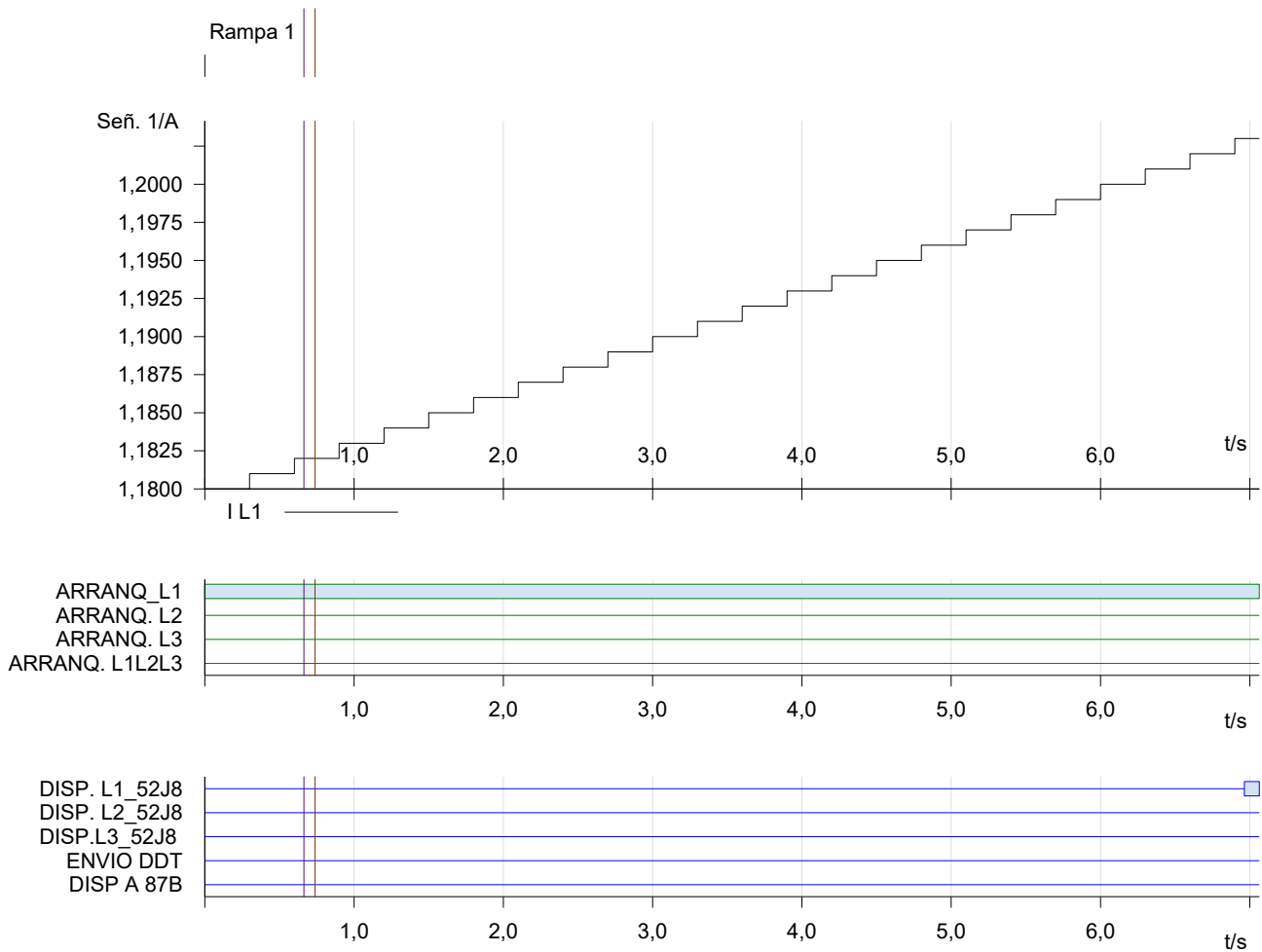
Magnitudes en rampa

I L1 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	1,180 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz

I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,205 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ. L1	1
ARRANQ. L2	0
ARRANQ. L3	0
ARRANQ. L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	26
Tiempo de rampa	7,800s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	1
DISP. L2_52J8	X
DISP.L3_52J8	X
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	100,0 ms



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	663,9 ms	<ninguno>	n/a
Cursor 2	737,6 ms	<ninguno>	n/a
C2 - C1	73,70 ms		n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

5.2 Pickup sin Arranque Fase L1:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de rampa: 1
Pasos totales por prueba: 121
Tiempo total por prueba: 36,300 s
Nº de ejecuciones de prueba: 1

Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

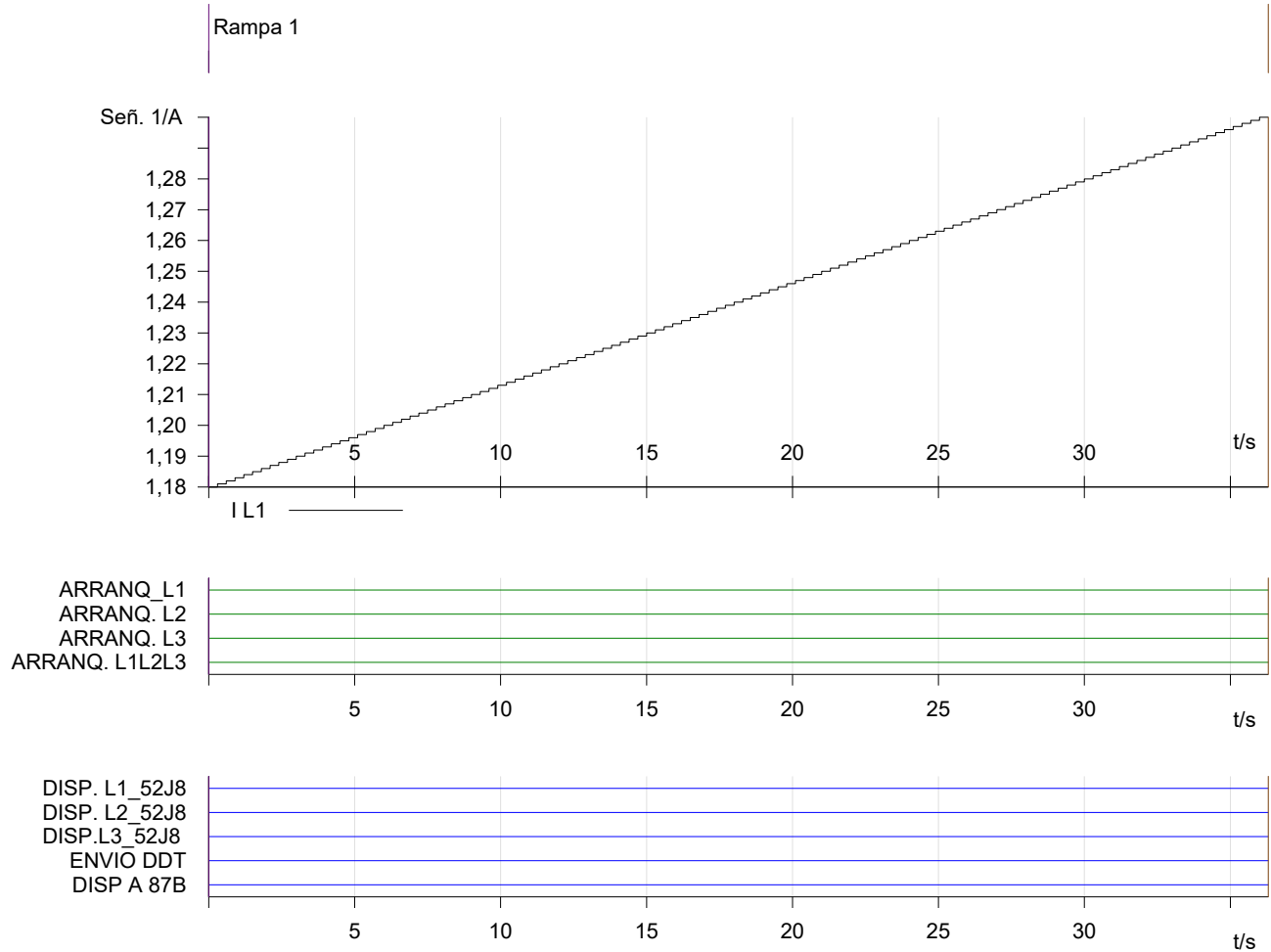
Magnitudes en rampa

I L1 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	1,180 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ_L1	0
ARRANQ. L2	0
ARRANQ. L3	0
ARRANQ. L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	121
Tiempo de rampa	36,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	1
DISP. L2_52J8	X
DISP.L3_52J8	X
ENVIO DDT	X

DISP A 87B	X
Paso atrás	Sí
Tiempo de retardo	100,0 ms



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	36,30 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	36,30 s		n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

-----Group end:5. Verificacion Pickup 50BF Fase L1-----
-----Group:6. Verificacion Pickup 50BF Fase L2-----

6.1 Pickup con Arranque Fase L2:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de
rampa: 1
Pasos totales por
prueba: 121
Tiempo total por
prueba: 36,300 s
Nº de ejecuciones de
prueba: 1

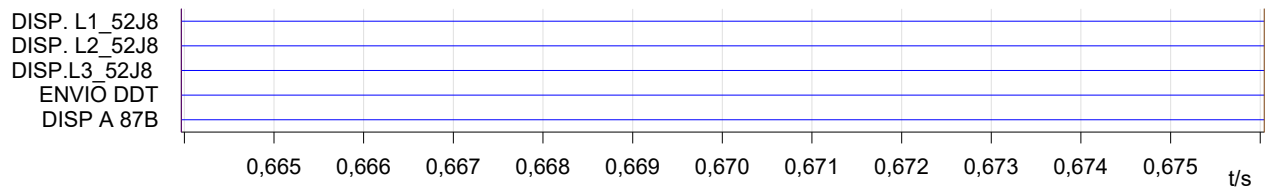
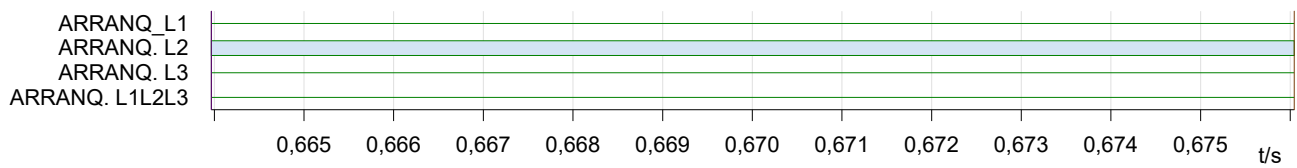
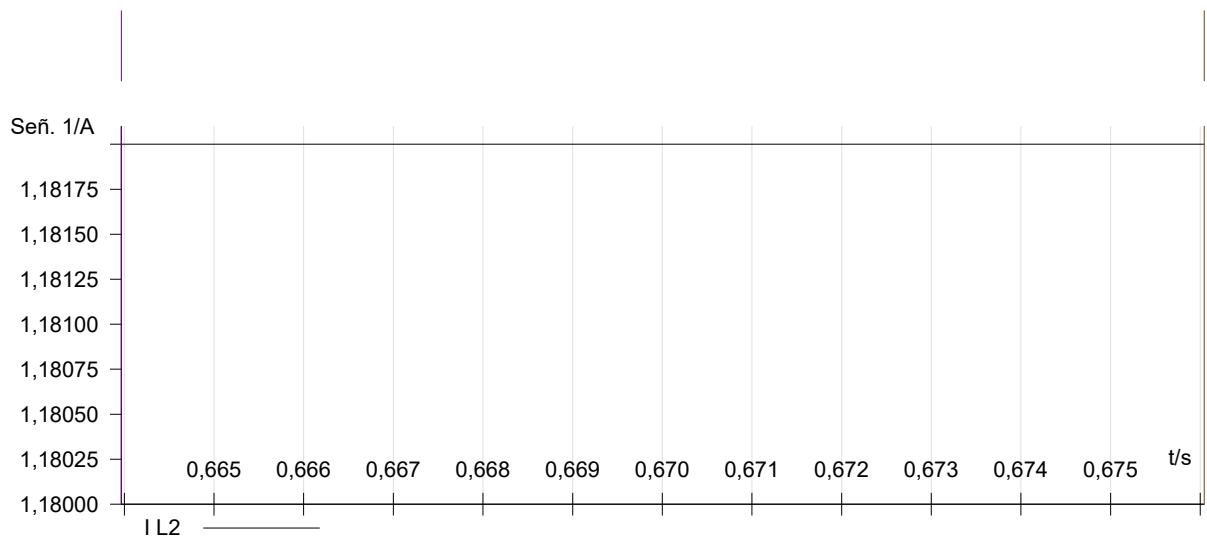
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

Magnitudes en rampa

I L2 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	<u>1,180 A</u> -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ. L1	0
ARRANQ. L2	1
ARRANQ. L3	0
ARRANQ. L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	121
Tiempo de rampa	36,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	X
DISP. L2_52J8	1
DISP.L3_52J8	X
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
Paso atrás	Sí
Tiempo de retardo	20,00 ms



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	13,04 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	13,04 s		n/a

Estado de la prueba:

Prueba correcta

6.2 Pickup sin Arranque Fase L2:

Ajustes de la prueba

General

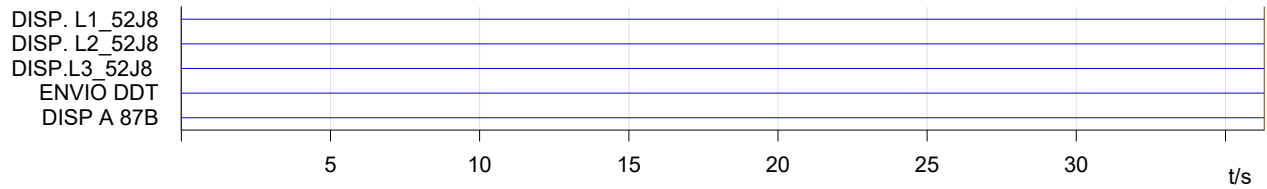
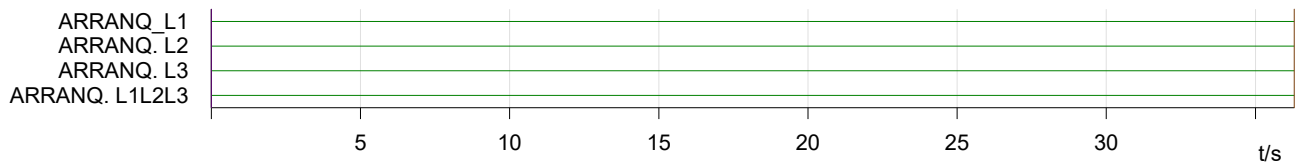
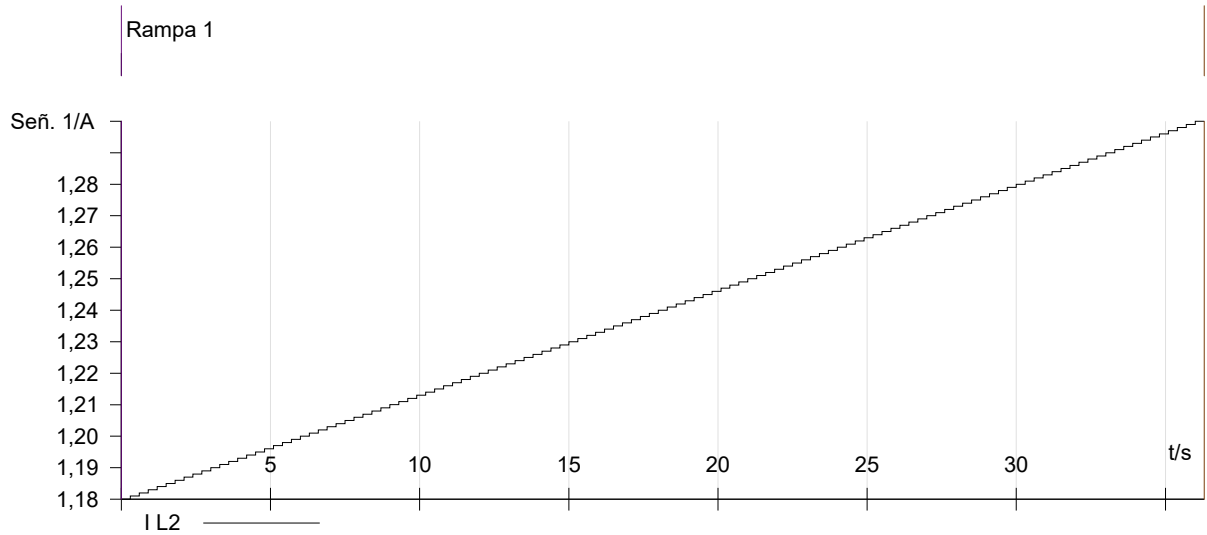
Nº de estados de
rampa: 1
Pasos totales por
prueba: 121
Tiempo total por
prueba: 36,300 s
Nº de ejecuciones de
prueba: 1
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

Magnitudes en rampa

I L2 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	<u>1,180 A</u> -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ. L1	0
ARRANQ. L2	0
ARRANQ. L3	0
ARRANQ. L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	121
Tiempo de rampa	36,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	X
DISP. L2_52J8	1
DISP.L3_52J8	X
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	0,000 s



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	36,30 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	36,30 s		n/a

Estado de la prueba:

Prueba correcta

-----Group end:6. Verificacion Pickup 50BF Fase L2-----

-----Group:7. Verificacion Pickup 50BF Fase L3-----

7.1 Pickup con Arranque Fase L3:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de
rampa: 1
Pasos totales por
prueba: 25
Tiempo total por
prueba: 7,500 s
Nº de ejecuciones de
prueba: 1

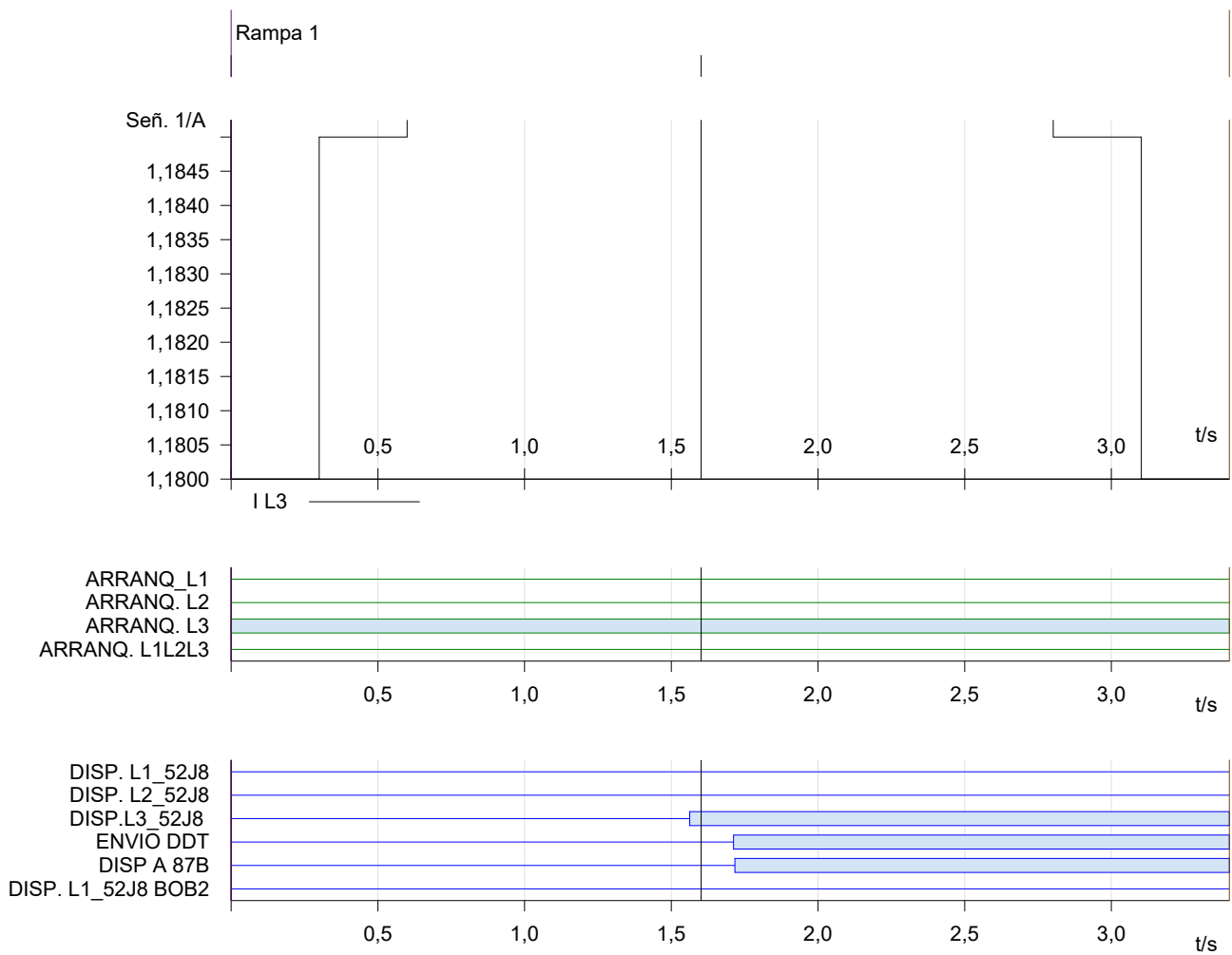
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

Magnitudes en rampa

I L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	<u>1,180 A</u> 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	5,000 mA
Señ. 1 d/dt	16,67 mA/s
ARRANQ. L1	0
ARRANQ. L2	0
ARRANQ. L3	1
ARRANQ. L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	25
Tiempo de rampa	7,500s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	X
DISP. L2_52J8	X
DISP.L3_52J8	1
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
DISP. L1_52J8 BOB2	X
Paso atrás	Sí
Tiempo de retardo	20,00 ms



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	3,402 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	3,402 s		n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

7.2 Pickup sin Arranque Fase L3:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de
rampa: 1
Pasos totales por
prueba: 121
Tiempo total por
prueba: 36,300 s
Nº de ejecuciones de
prueba: 1

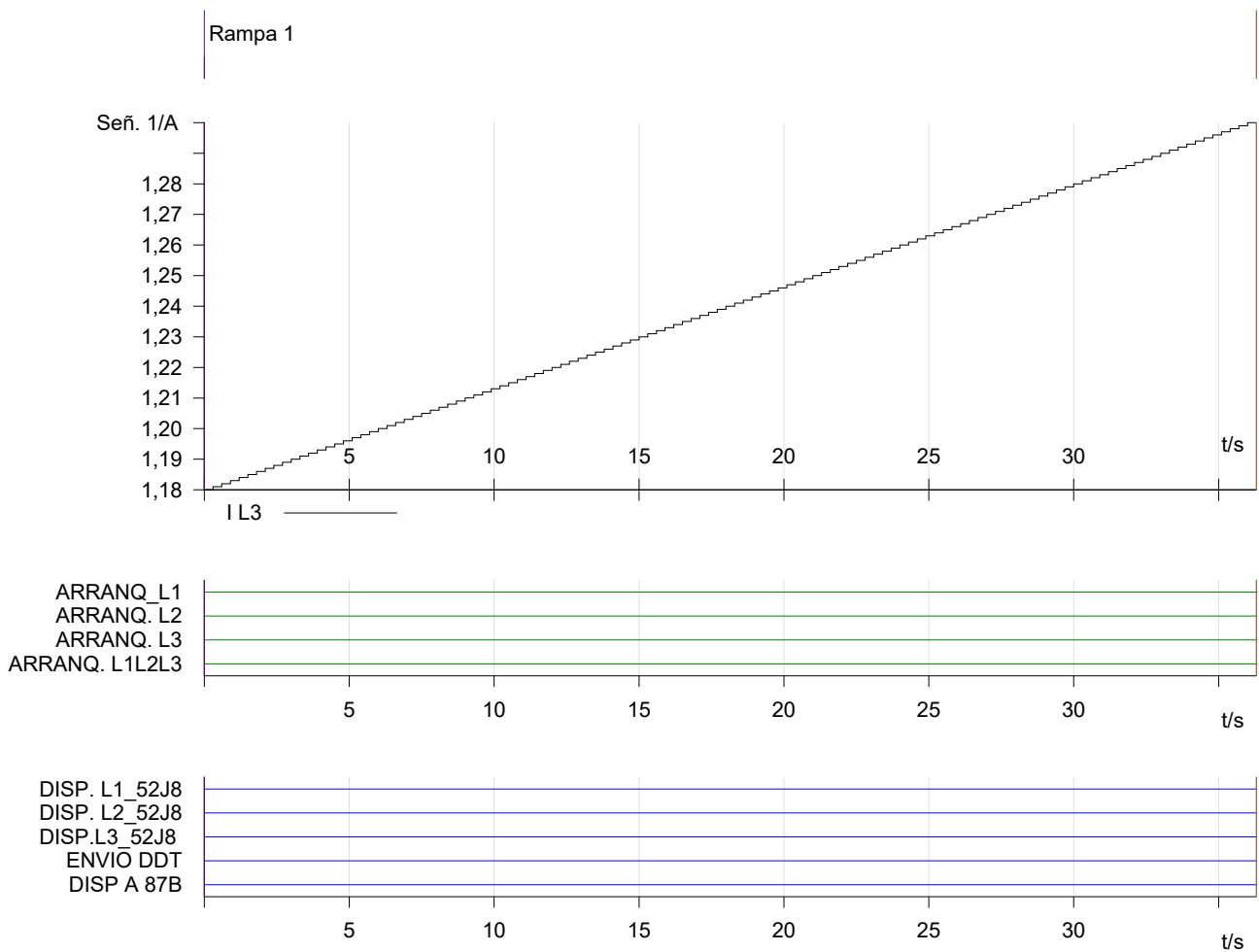
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

Magnitudes en rampa

I L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	<u>1,180 A</u> 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ. L1	0
ARRANQ. L2	0
ARRANQ. L3	0
ARRANQ. L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	121
Tiempo de rampa	36,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	X
DISP. L2_52J8	X
DISP.L3_52J8	1
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	0,000 s



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	36,30 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	36,30 s		n/a

Estado de la prueba:

Prueba correcta

-----Group end:7. Verificacion Pickup 50BF Fase L3-----

-----Group:8. Verificacion Pickup 50BF Fases L123-----

8.1 Pickup con Arranque Fases L123:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de
rampa: 1
Pasos totales por
prueba: 121
Tiempo total por
prueba: 36,300 s
Nº de ejecuciones de
prueba: 1

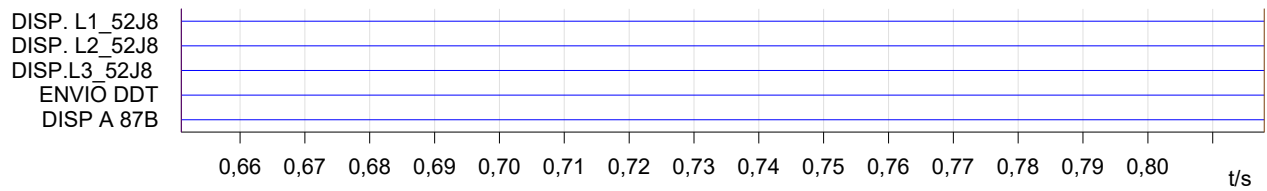
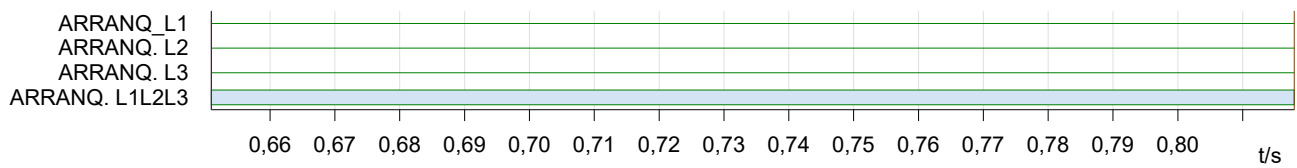
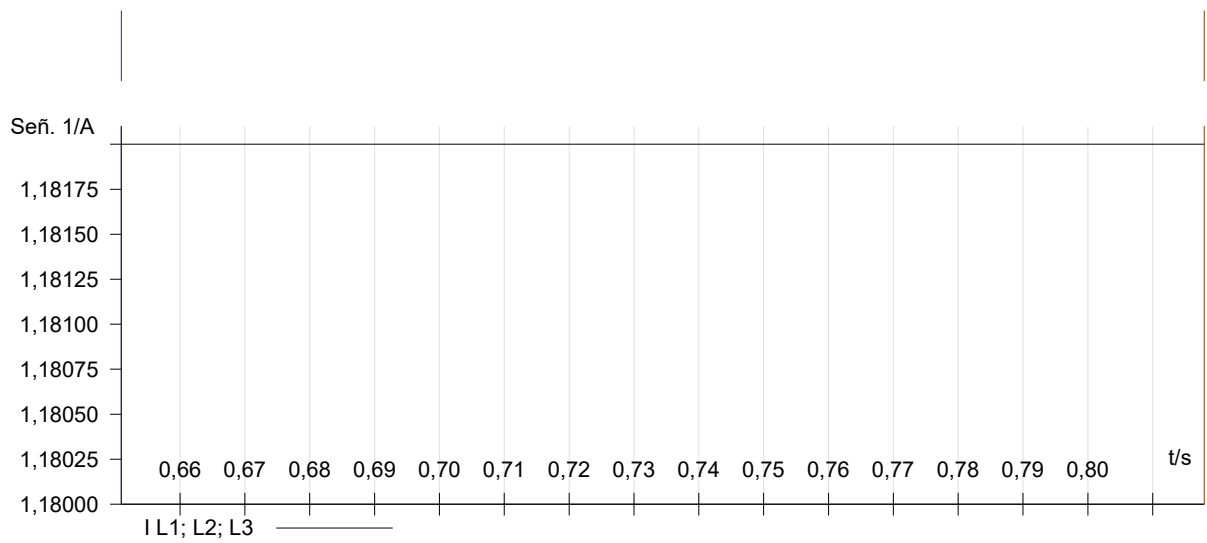
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

Magnitudes en rampa

I L1; L2; L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	<u>1,180 A</u> 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	<u>1,180 A</u> -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	<u>1,180 A</u> 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ_L1	0
ARRANQ_L2	0
ARRANQ_L3	0
ARRANQ_L1L2L3	1
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	121
Tiempo de rampa	36,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	AND
DISP. L1_52J8	1
DISP. L2_52J8	1
DISP.L3_52J8	1
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
Paso atrás	Sí
Tiempo de retardo	20,00 ms



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	13,03 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	13,03 s		n/a

Estado de la prueba:

Prueba correcta

8.2 Pickup sin Arranque Fases L123:

Ajustes de la prueba

General

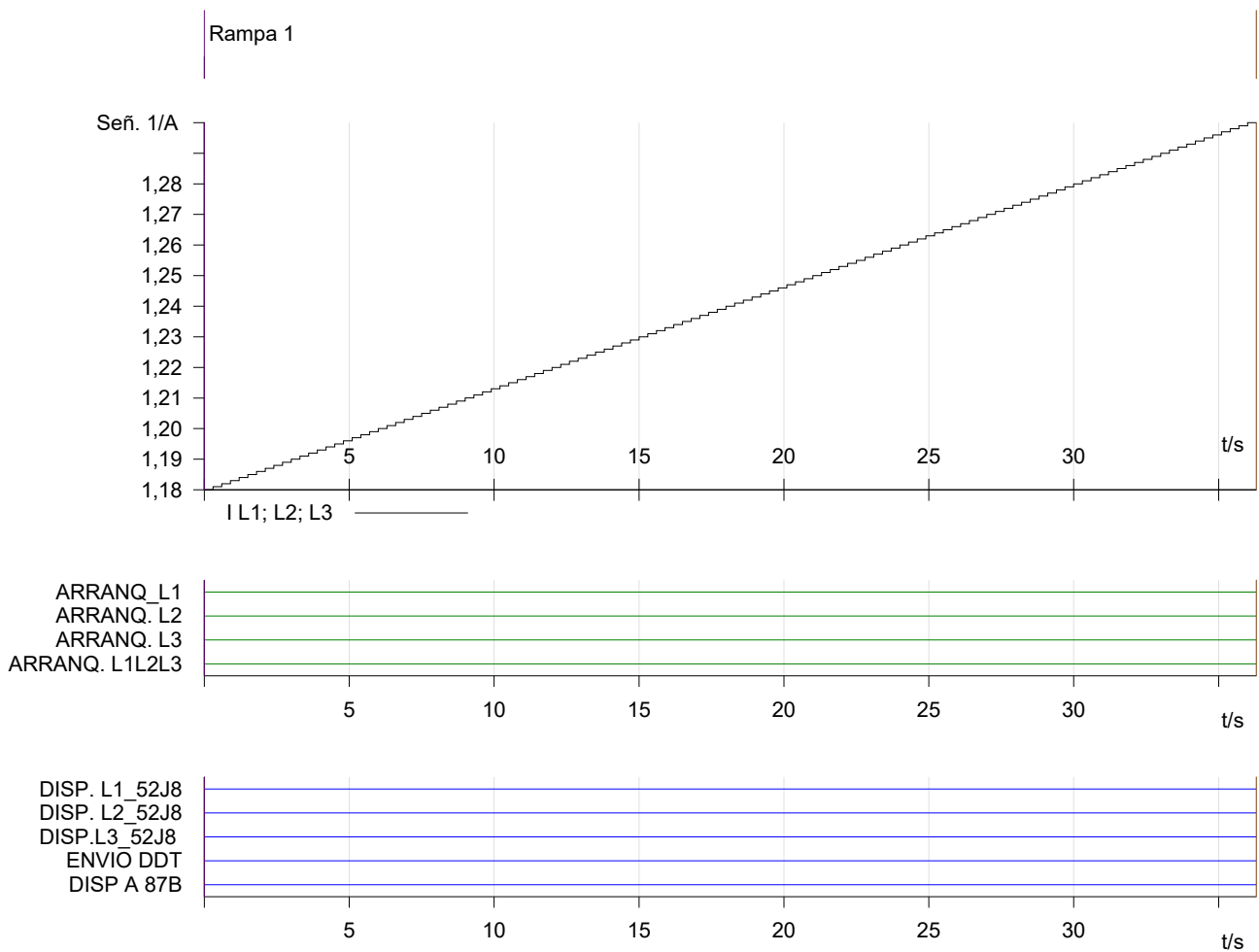
Nº de estados de
rampa: 1
Pasos totales por
prueba: 121
Tiempo total por
prueba: 36,300 s
Nº de ejecuciones de
prueba: 1
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

Magnitudes en rampa

I L1; L2; L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	<u>1,180 A</u> 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	<u>1,180 A</u> -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	<u>1,180 A</u> 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	1,180 A
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	1,000 mA
Señ. 1 d/dt	3,333 mA/s
ARRANQ_L1	0
ARRANQ_L2	0
ARRANQ_L3	0
ARRANQ_L1L2L3	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	121
Tiempo de rampa	36,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
DISP. L1_52J8	1
DISP. L2_52J8	1
DISP.L3_52J8	1
ENVIO DDT	X
DISP A 87B	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	0,000 s



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	36,30 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	36,30 s		n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

----- Group end:8. Verificacion Pickup 50BF Fases L123-----
 ----- Group:9. Operacion 50BF_J8 (T1)-----

9.1 Operacion 50BF_Fase L1 :

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL1+S/Arr anque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL1+C/Arr anque 50BF_L1	Post- Falla 3
IL1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz

IL2	0,000 A	0,000 A	0,000 A	0,000 A	0,000 A
	-120,00 °	-120,00 °	-120,00 °	-120,00 °	-120,00 °
	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz
IL3	0,000 A	0,000 A	0,000 A	0,000 A	0,000 A
	120,00 °	120,00 °	120,00 °	120,00 °	120,00 °
	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz

Módulo de prueba

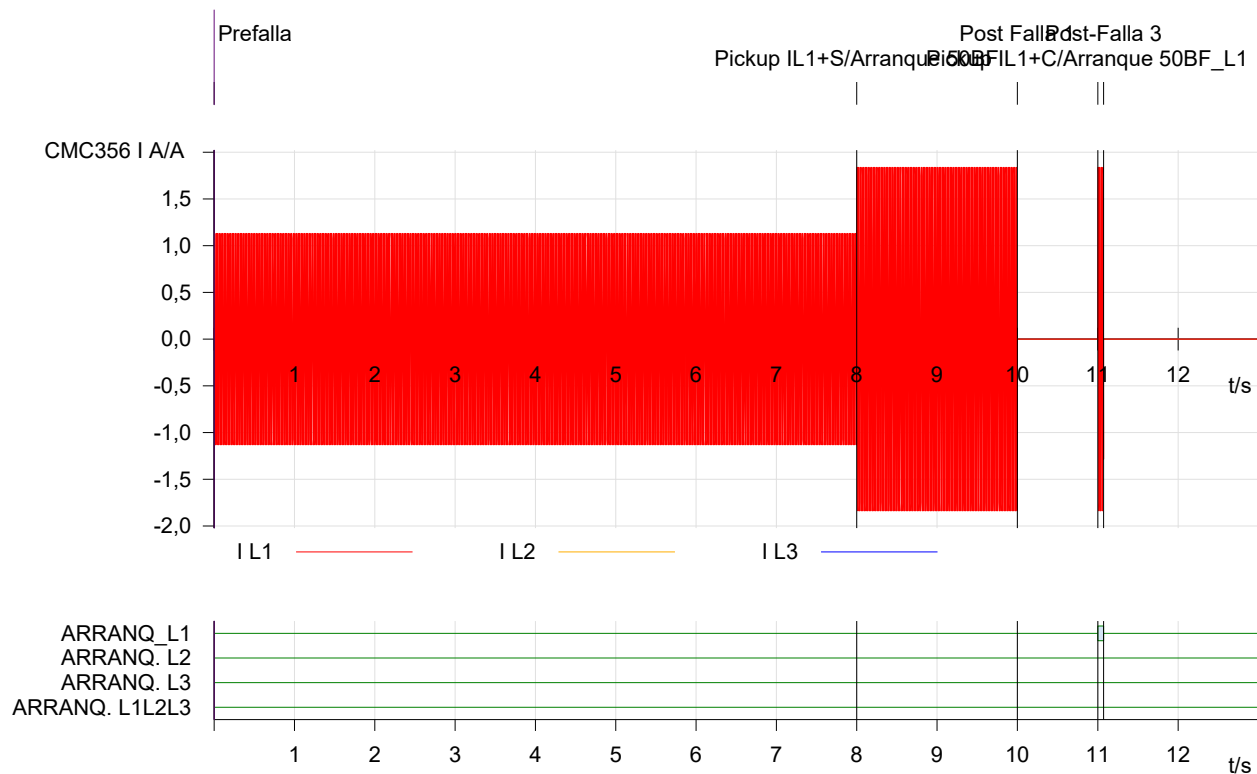
Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 15:21:30 Fin: 04-abr.-2019 15:21:45
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

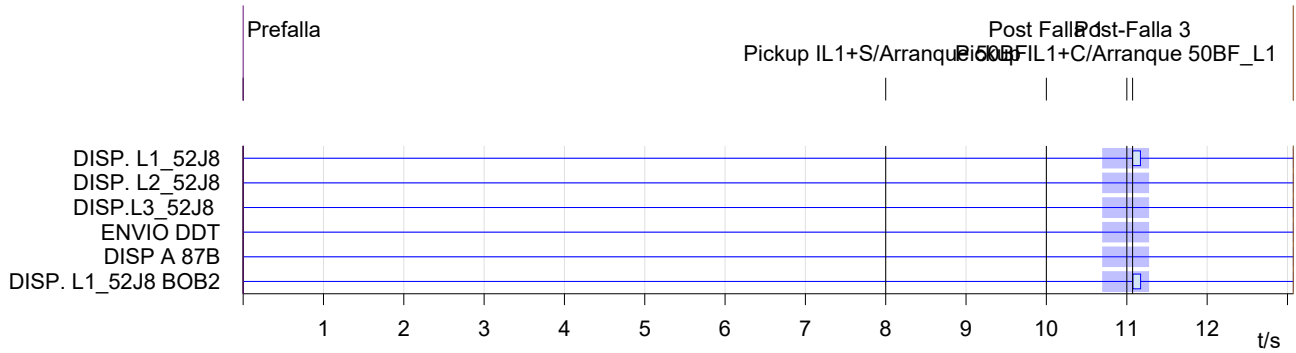
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL1+S/Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL1+C/Arranque 50BF_L1	Post- Falla 3
Eval.	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	1	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	0
DISP A 87B	0	0	0	0	0
DISP. L1_52J8 BOB2	0	0	0	0	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado





Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
11,00 s	Salida	ARRANQ_L1	0>1
11,07 s	Entrada	DISP. L1_52J8	0>1
11,07 s	Salida	ARRANQ_L1	1>0
11,08 s	Entrada	DISP. L1_52J8 BOB2	0>1
11,17 s	Entrada	DISP. L1_52J8	1>0
11,17 s	Entrada	DISP. L1_52J8 BOB2	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.2 Operacion 50BF_Fase L2 :

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL2+S/Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2	Post-Falla 2
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 12:16:46 Fin: 04-abr.-2019 12:16:55
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

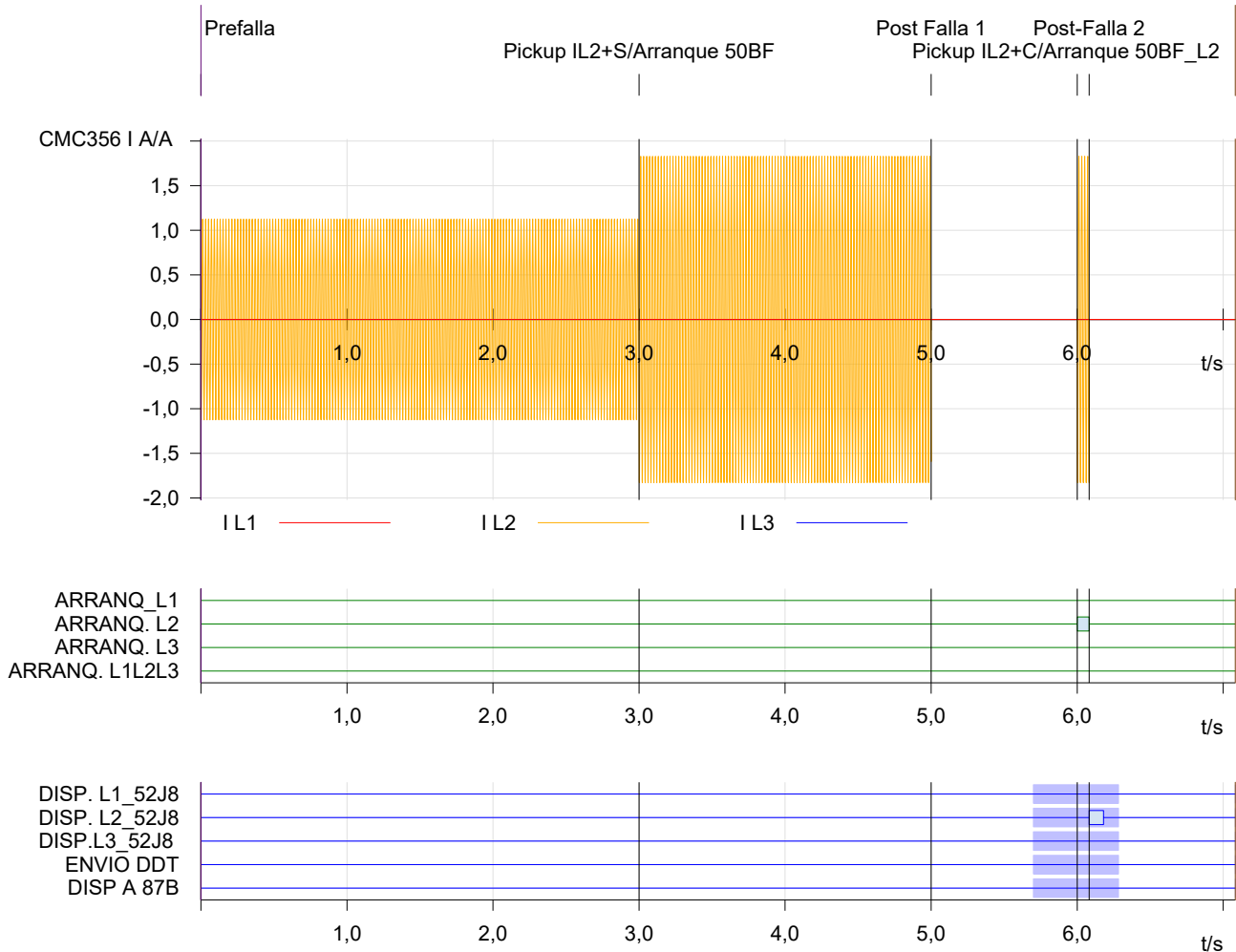
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL2+S/Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2	Post-Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+

Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	0	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	1	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	0
DISP A 87B	0	0	0	0	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
6,000 s	Salida	ARRANQ. L2	0>1
6,082 s	Entrada	DISP. L2_52J8	0>1
6,082 s	Salida	ARRANQ. L2	1>0
6,180 s	Entrada	DISP. L2_52J8	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.3 Operacion 50BF_Fase L3:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL3+S/Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3	Post-Falla 2
IL1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
IL2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
IL3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

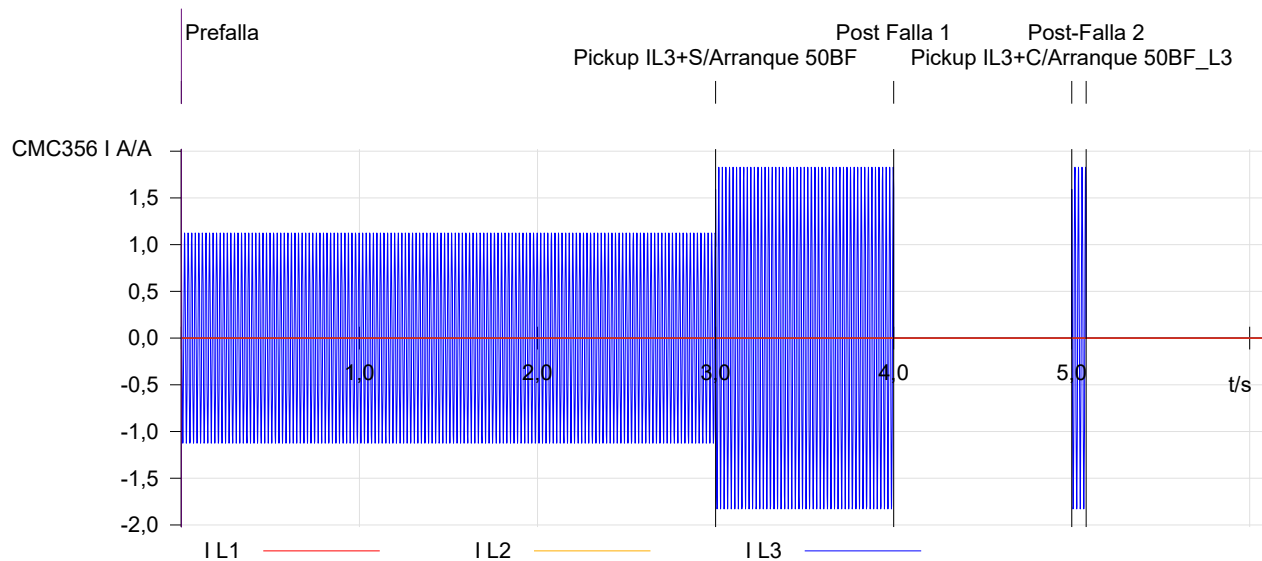
Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 12:19:01 Fin: 04-abr.-2019 12:19:08
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

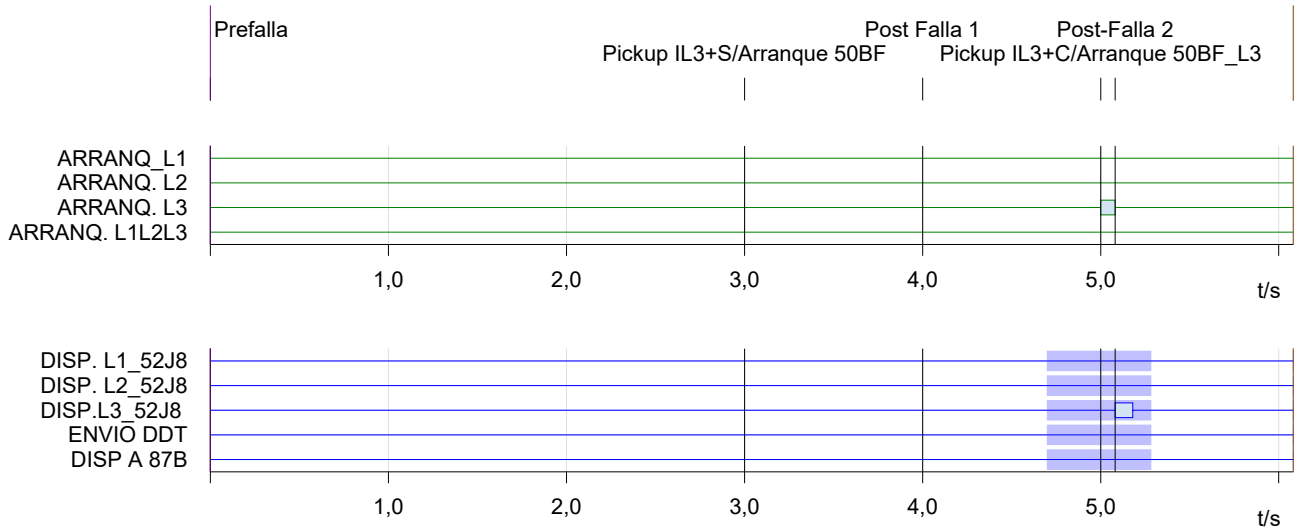
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL3+S/Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3	Post-Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	1	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	0
DISP A 87B	0	0	0	0	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado





Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
5,000 s	Salida	ARRANQ. L3	0>1
5,081 s	Entrada	DISP.L3_52J8	0>1
5,081 s	Salida	ARRANQ. L3	1>0
5,180 s	Entrada	DISP.L3_52J8	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.4 Operacion 50BF_Fase L123:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

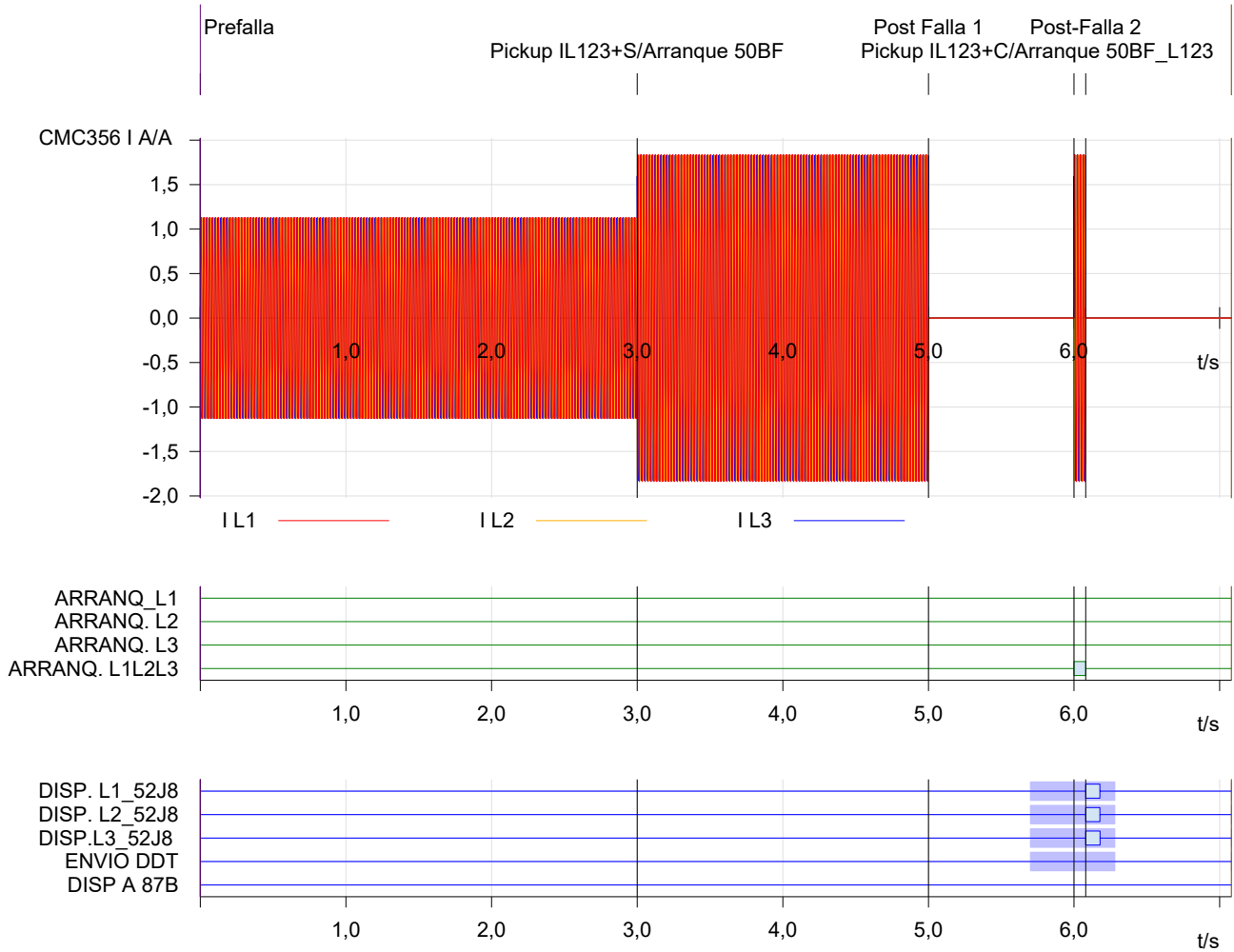
Nombre:	OMICRON State Sequencer	Versión:	4.00
Comienzo:	04-abr.-2019 11:23:38	Fin:	04-abr.-2019 11:23:47
Nombre de usuario:		Administrador:	
Compañía:			

Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	1	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	1	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	1	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
6,000 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	0>1
6,080 s	Entrada	DISP. L1_52J8	0>1
6,080 s	Entrada	DISP.L3_52J8	0>1
6,080 s	Entrada	DISP. L2_52J8	0>1
6,080 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	1>0
6,178 s	Entrada	DISP. L2_52J8	1>0
6,178 s	Entrada	DISP. L1_52J8	1>0
6,178 s	Entrada	DISP.L3_52J8	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

9.4 Operacion 50BF_Fase L123_BOB 2:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 15:23:13 Fin: 04-abr.-2019 15:23:27
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

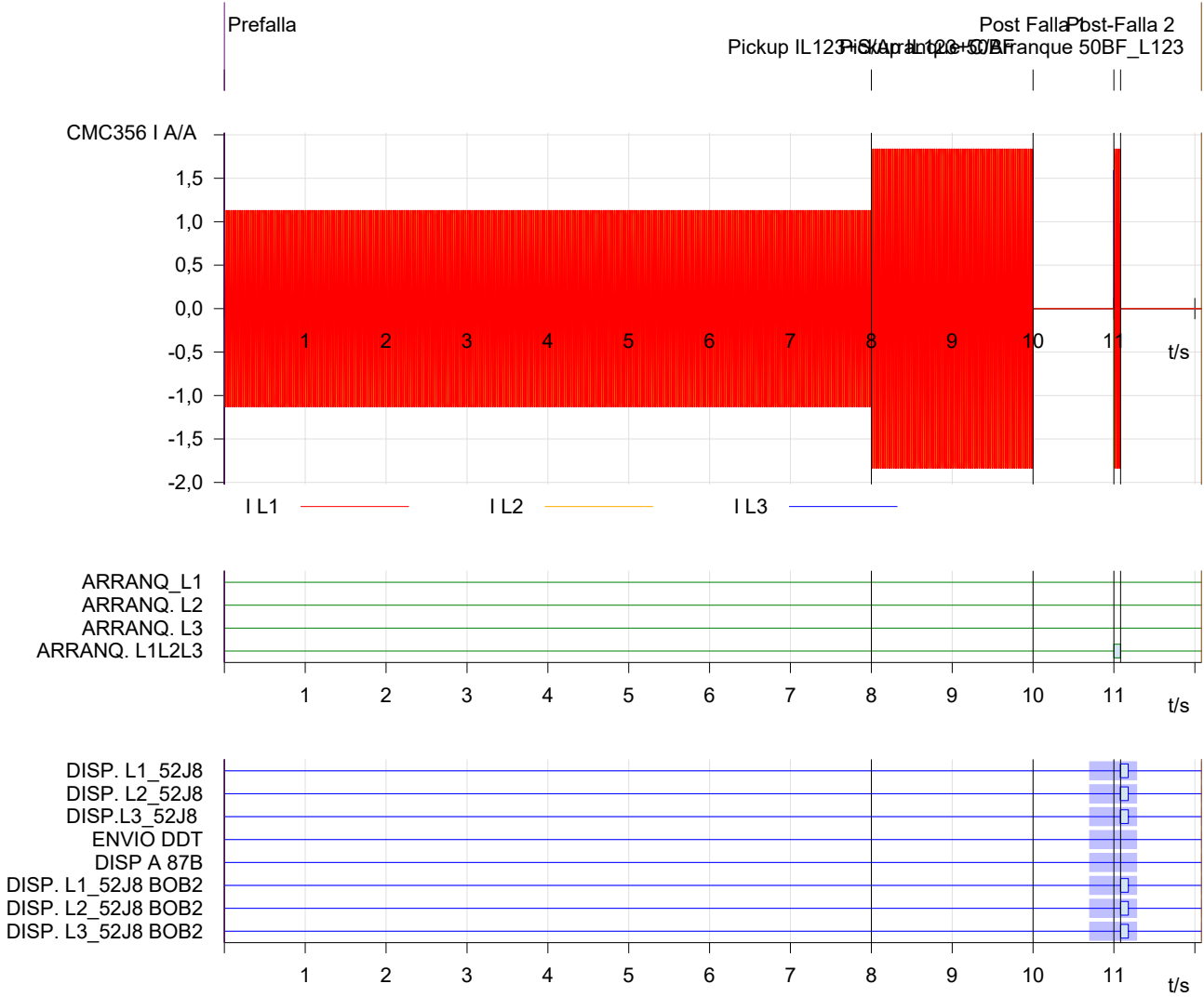
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF	Post Falla 1	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	200,0 ms

DISP. L1_52J8	0	0	0	1	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	1	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	1	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	0
DISP A 87B	0	0	0	0	0
DISP. L1_52J8 BOB2	0	0	0	0	0
DISP. L2_52J8 BOB2	0	0	0	1	0
DISP. L3_52J8 BOB2	0	0	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
11,00 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L2_52J8	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L1_52J8	0>1
11,08 s	Entrada	DISP.L3_52J8	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L2_52J8 BOB2	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L1_52J8 BOB2	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L3_52J8 BOB2	0>1
11,08 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	1>0
11,18 s	Entrada	DISP. L1_52J8	1>0
11,18 s	Entrada	DISP. L2_52J8	1>0
11,18 s	Entrada	DISP.L3_52J8	1>0
11,18 s	Entrada	DISP. L1_52J8 BOB2	1>0
11,18 s	Entrada	DISP. L3_52J8 BOB2	1>0
11,18 s	Entrada	DISP. L2_52J8 BOB2	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

----- Group end:9. Operacion 50BF_J8 (T1)-----

----- Group:10. Operacion 50BF_J8 (T1 and T2)-----

10.1 Operacion 50BF_Fase L1 :

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL1+S/Arr aque 50BF_L1	Post Falla 1	Pickup IL1+C/Arr aque 50BF_L1 (1)	Pickup IL1+C/Arr aque 50BF_L1 (2)	Post- Falla 2
IL1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
IL2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
IL3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 15:27:47 Fin: 04-abr.-2019 15:28:01
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

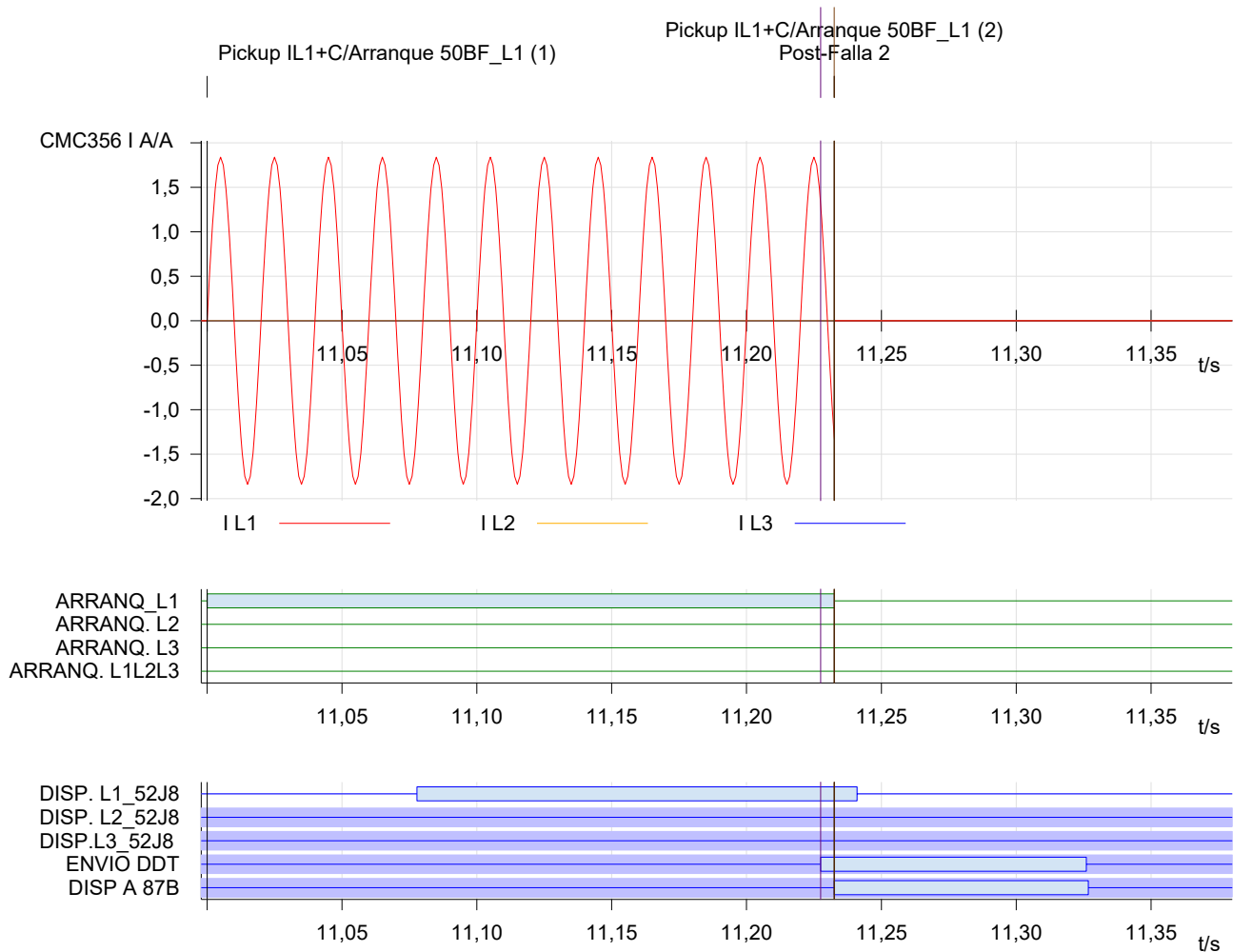
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL1+S/Arr aque 50BF_L1	Post Falla 1	Pickup IL1+C/Arr aque 50BF_L1 (1)	Pickup IL1+C/Arr aque 50BF_L1 (2)	Post- Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	500,0 ms	200,0 ms

DISP. L2_52J8	0	0	0	0	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	0	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	1	0
DISP A 87B	0	0	0	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
11,00 s	Salida	ARRANQ_L1	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L1_52J8	0>1
11,23 s	Entrada	ENVIO DDT	0>1
11,23 s	Entrada	DISP A 87B	0>1
11,23 s	Salida	ARRANQ_L1	1>0
11,24 s	Entrada	DISP. L1_52J8	1>0
11,33 s	Entrada	ENVIO DDT	1>0
11,33 s	Entrada	DISP A 87B	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.2 Operacion 50BF_Fase L2:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL2+S/Arranque 50BF_L2	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2	Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2	Post-Falla 2
IL1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
IL2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
IL3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

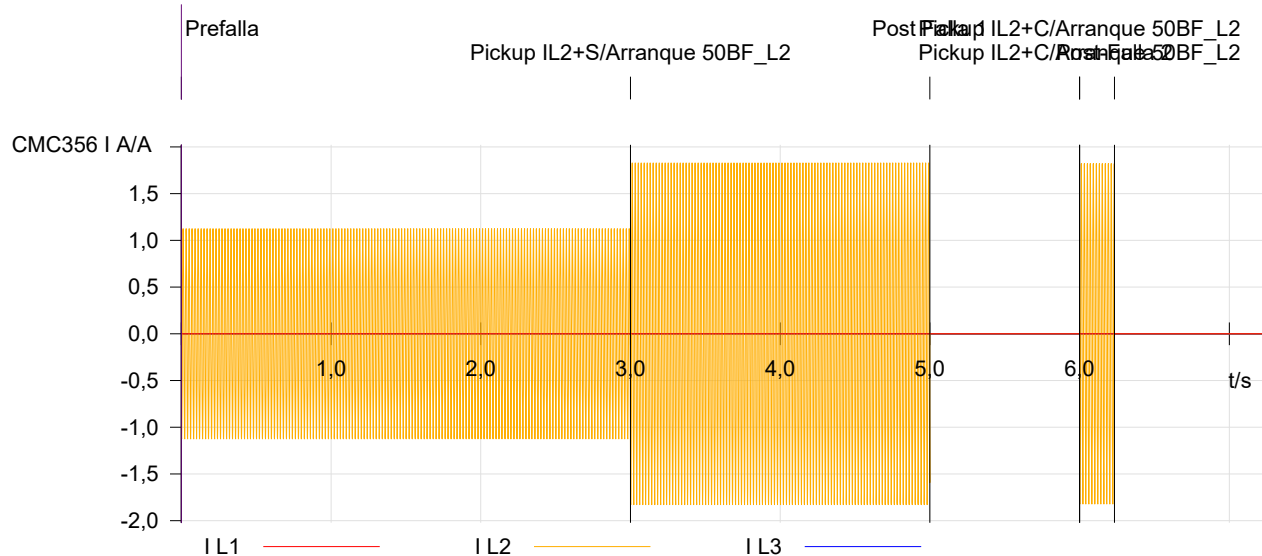
Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 12:21:39 Fin: 04-abr.-2019 12:21:48
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

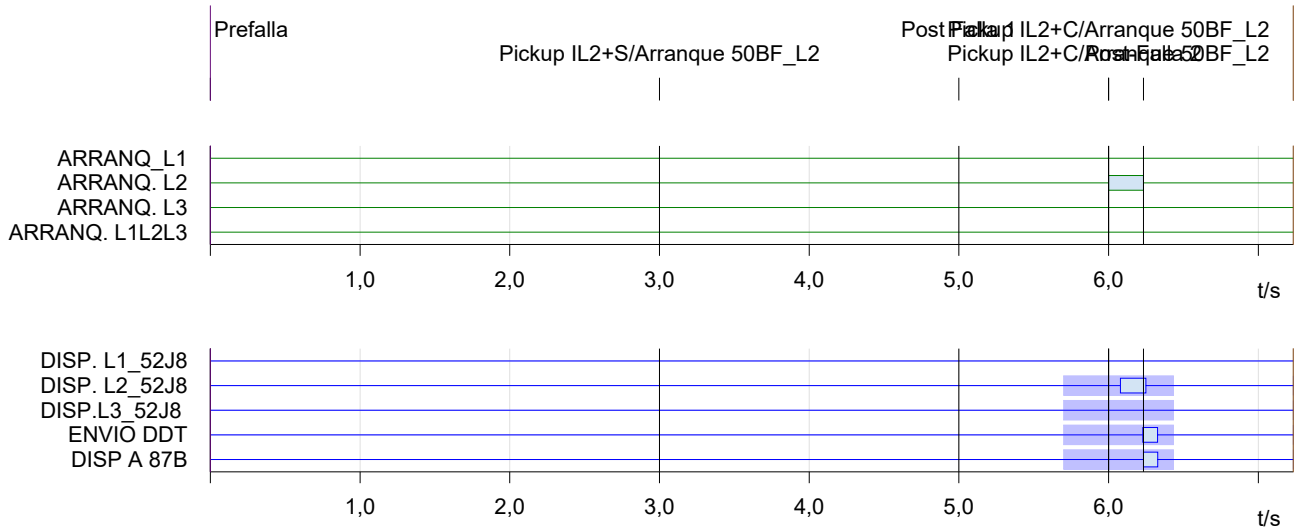
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL2+S/Arranque 50BF_L2	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2	Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L2	Post-Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L2_52J8	0	0	0	1	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	0	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	1	0
DISP A 87B	0	0	0	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado





Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
6,000 s	Salida	ARRANQ. L2	0>1
6,079 s	Entrada	DISP. L2_52J8	0>1
6,229 s	Entrada	ENVIO DDT	0>1
6,233 s	Entrada	DISP A 87B	0>1
6,233 s	Salida	ARRANQ. L2	1>0
6,249 s	Entrada	DISP. L2_52J8	1>0
6,327 s	Entrada	ENVIO DDT	1>0
6,328 s	Entrada	DISP A 87B	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.3 Operacion 50BF_Fase L3:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL3+S/Arranque 50BF_L3	Post-Falla 1	Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3	Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3	Post-Falla 3
IL1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
IL2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
IL3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

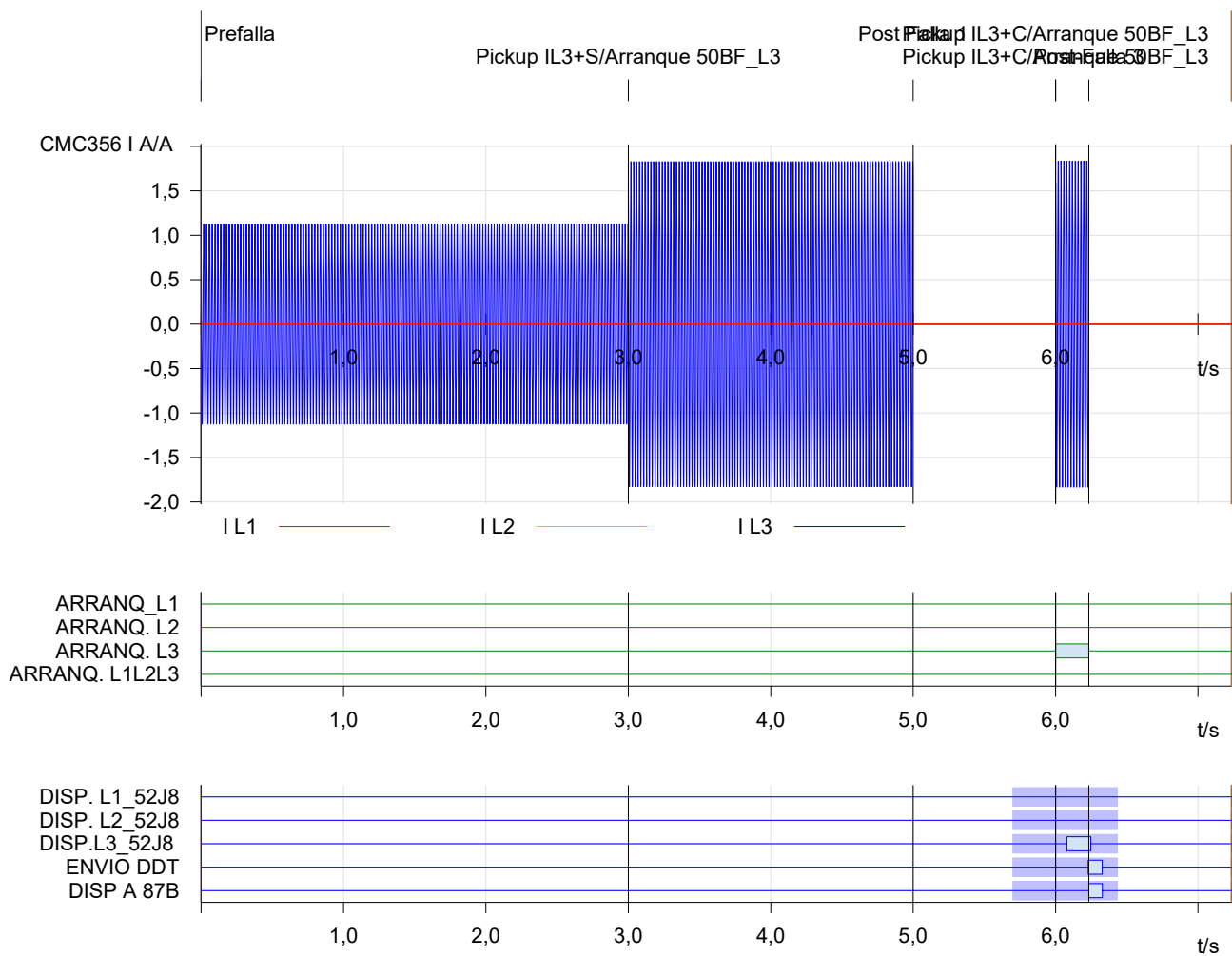
Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 12:23:29 Fin: 04-abr.-2019 12:23:38
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL3+S/Arranque 50BF_L3	Post Falla 1	Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3	Pickup IL3+C/Arranque 50BF_L3	Post-Falla 3
Eval.	+	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	0	0	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	0	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	1	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	1	0
DISP A 87B	0	0	0	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
6,000 s	Salida	ARRANQ. L3	0>1
6,079 s	Entrada	DISP.L3_52J8	0>1
6,229 s	Entrada	ENVIO DDT	0>1
6,234 s	Entrada	DISP A 87B	0>1
6,234 s	Salida	ARRANQ. L3	1>0
6,247 s	Entrada	DISP.L3_52J8	1>0
6,327 s	Entrada	ENVIO DDT	1>0
6,328 s	Entrada	DISP A 87B	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.4 Operacion 50BF_Fase L123:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF_L1 23	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arr anque 50BF_L1 23	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

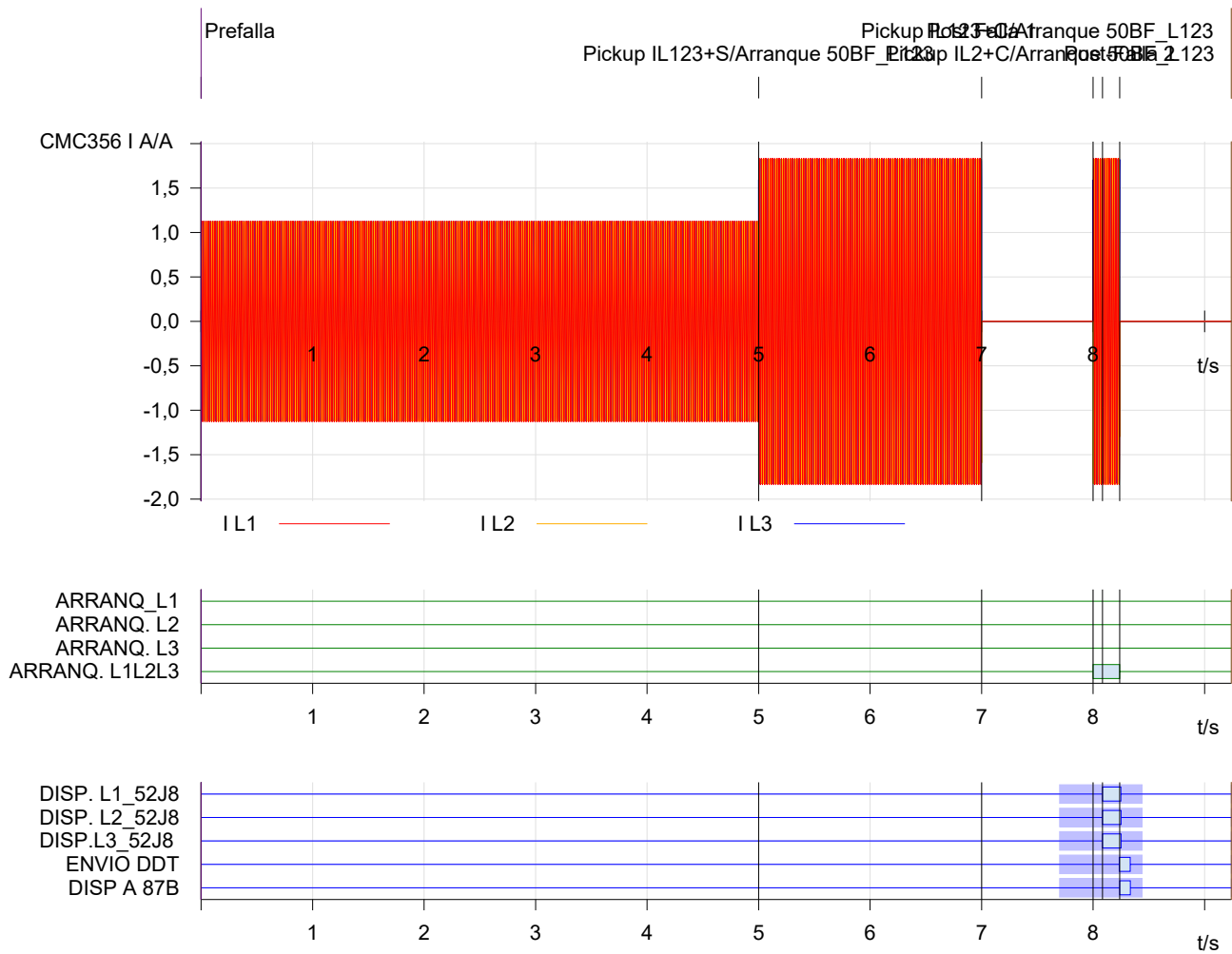
Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 11:43:46 Fin: 04-abr.-2019 11:43:56
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF_L1 23	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arr anque 50BF_L1 23	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	1	0	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	1	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	1	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	1	0
DISP A 87B	0	0	0	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
8,000 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	0>1
8,085 s	Entrada	DISP.L3_52J8	0>1
8,085 s	Entrada	DISP. L1_52J8	0>1
8,085 s	Entrada	DISP. L2_52J8	0>1
8,235 s	Entrada	ENVIO DDT	0>1
8,239 s	Entrada	DISP A 87B	0>1
8,239 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	1>0
8,250 s	Entrada	DISP. L1_52J8	1>0
8,251 s	Entrada	DISP. L2_52J8	1>0
8,251 s	Entrada	DISP.L3_52J8	1>0
8,333 s	Entrada	ENVIO DDT	1>0
8,334 s	Entrada	DISP A 87B	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.4 Operacion 50BF_Fase L123 BOB2:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF_L1 23	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arr anque 50BF_L1 23	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
IL1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
IL2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
IL3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 15:40:13 Fin: 04-abr.-2019 15:40:27
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

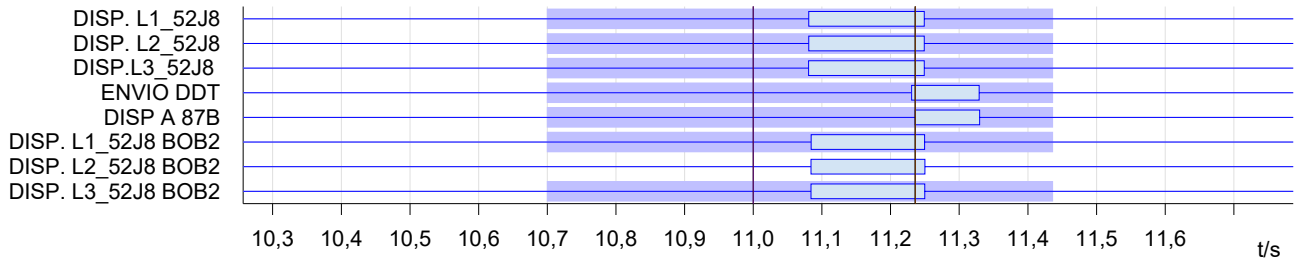
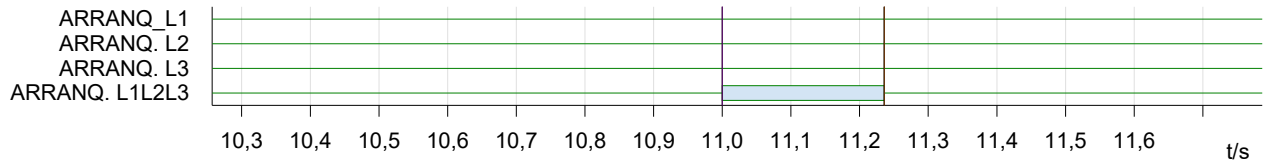
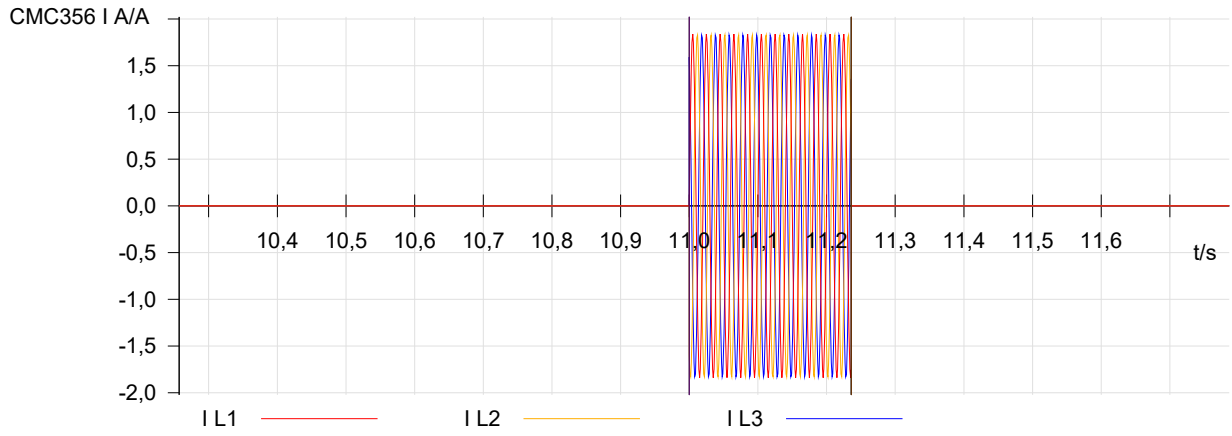
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL123+S/ Arranque 50BF_L1 23	Post Falla 1	Pickup IL2+C/Arr anque 50BF_L1 23	Pickup IL123+C/ Arranque 50BF_L1 23	Post- Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	300,0 ms	200,0 ms
DISP. L1_52J8	0	0	0	1	0	0
DISP. L2_52J8	0	0	0	1	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	1	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	1	0
DISP A 87B	0	0	0	0	1	0
DISP. L1_52J8 BOB2	0	0	0	0	1	0
DISP. L3_52J8 BOB2	0	0	0	1	0	0

Eval.: +.. Correcto x.. Incorrecto o.. No evaluado

Pickup IL123+Pstalla 2
 Pickup IL2+C/Arranque 50BF_L123



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
11,00 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	0>1
11,08 s	Entrada	DISP.L3_52J8	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L1_52J8	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L2_52J8	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L3_52J8 BOB2	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L2_52J8 BOB2	0>1
11,08 s	Entrada	DISP. L1_52J8 BOB2	0>1
11,23 s	Entrada	ENVIO DDT	0>1
11,24 s	Entrada	DISP A 87B	0>1
11,24 s	Salida	ARRANQ. L1L2L3	1>0
11,25 s	Entrada	DISP. L2_52J8	1>0
11,25 s	Entrada	DISP. L1_52J8	1>0
11,25 s	Entrada	DISP.L3_52J8	1>0
11,25 s	Entrada	DISP. L1_52J8 BOB2	1>0
11,25 s	Entrada	DISP. L3_52J8 BOB2	1>0
11,25 s	Entrada	DISP. L2_52J8 BOB2	1>0
11,33 s	Entrada	ENVIO DDT	1>0
11,33 s	Entrada	DISP A 87B	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

10.5 Operación 50BF_ L1_ Caso 1:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Pickup IL1+S/Arr anque 50BF_L1	Post Falla 1	Pickup IL1+C/Arr anque 50BF_L1 (1)	Pickup IL1+C/Arr anque 50BF_L1 (2)	Post- Falla 2
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	1,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer Versión: 4.00
 Comienzo: 04-abr.-2019 15:45:01 Fin: 04-abr.-2019 15:45:16
 Nombre de usuario: Administrador:
 Compañía:

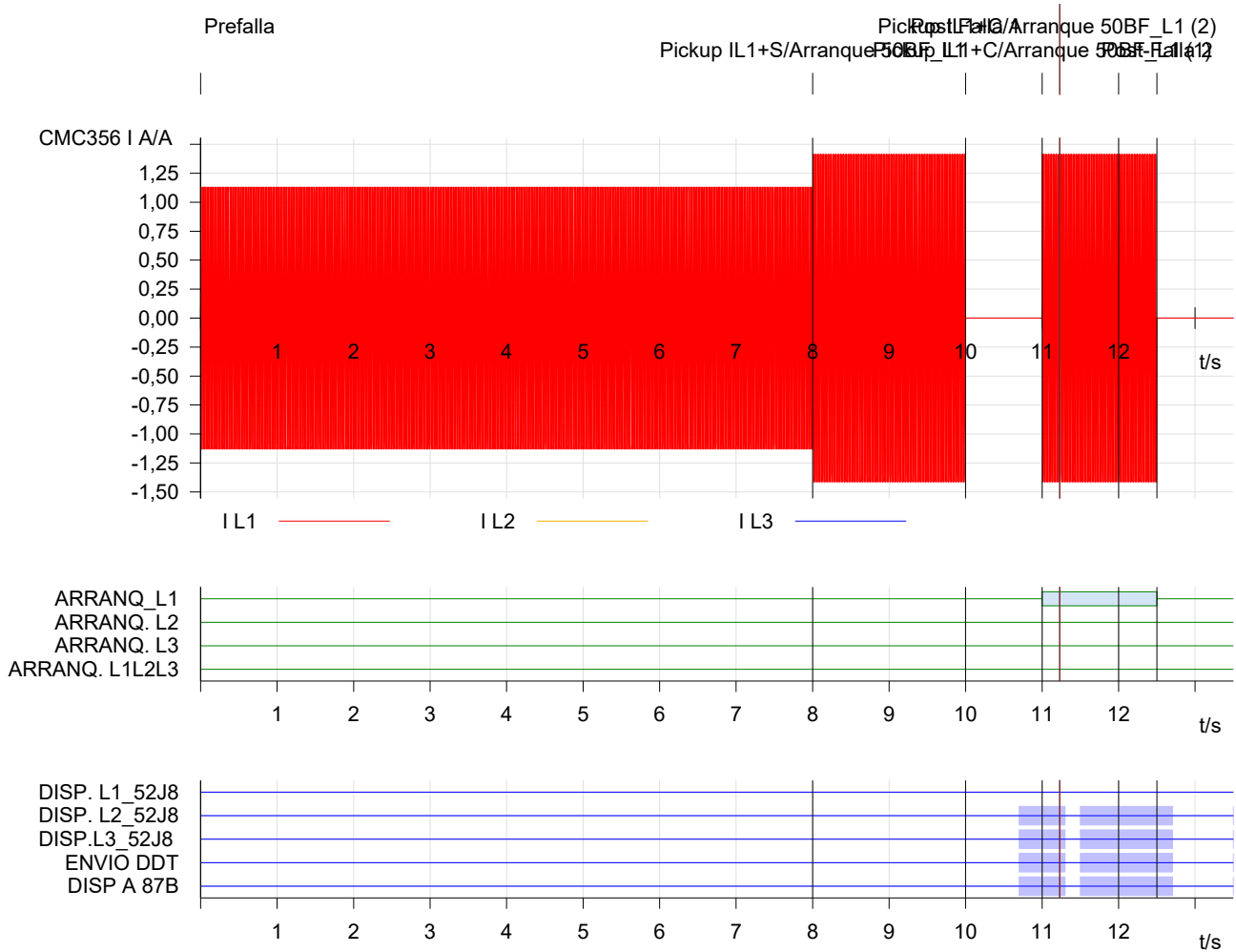
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Pickup IL1+S/Arr anque 50BF_L1	Post Falla 1	Pickup IL1+C/Arr anque 50BF_L1 (1)	Pickup IL1+C/Arr anque 50BF_L1 (2)	Post- Falla 2
Eval.	+	+	+	+	+	+

Tolerancia	0,000 s	0,000 s	0,000 s	300,0 ms	500,0 ms	200,0 ms
DISP. L2_52J8	0	0	0	0	0	0
DISP.L3_52J8	0	0	0	0	0	0
ENVIO DDT	0	0	0	0	1	0
DISP A 87B	0	0	0	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
11,00 s	Salida	ARRANQ_L1	0>1
12,50 s	Salida	ARRANQ_L1	1>0

Estado de la prueba:
Prueba incorrecta

-----Group end:10. Operacion 50BF_J8 (T1 and T2)-----

-----Group:11. Operacion End Fault_50BF E0-----

Hardware

Equipo en prueba

Tipo	No de serie
CMC356	MC355V

Comprobación del hardware

Realizado en	Resultado	Detalles
04-04-2019 13:54:53	Correcta	

Group:11.1 Verificacion Pickup

11.1.1 Pickup Fase L1 End Fault:

Ajustes de la prueba

General

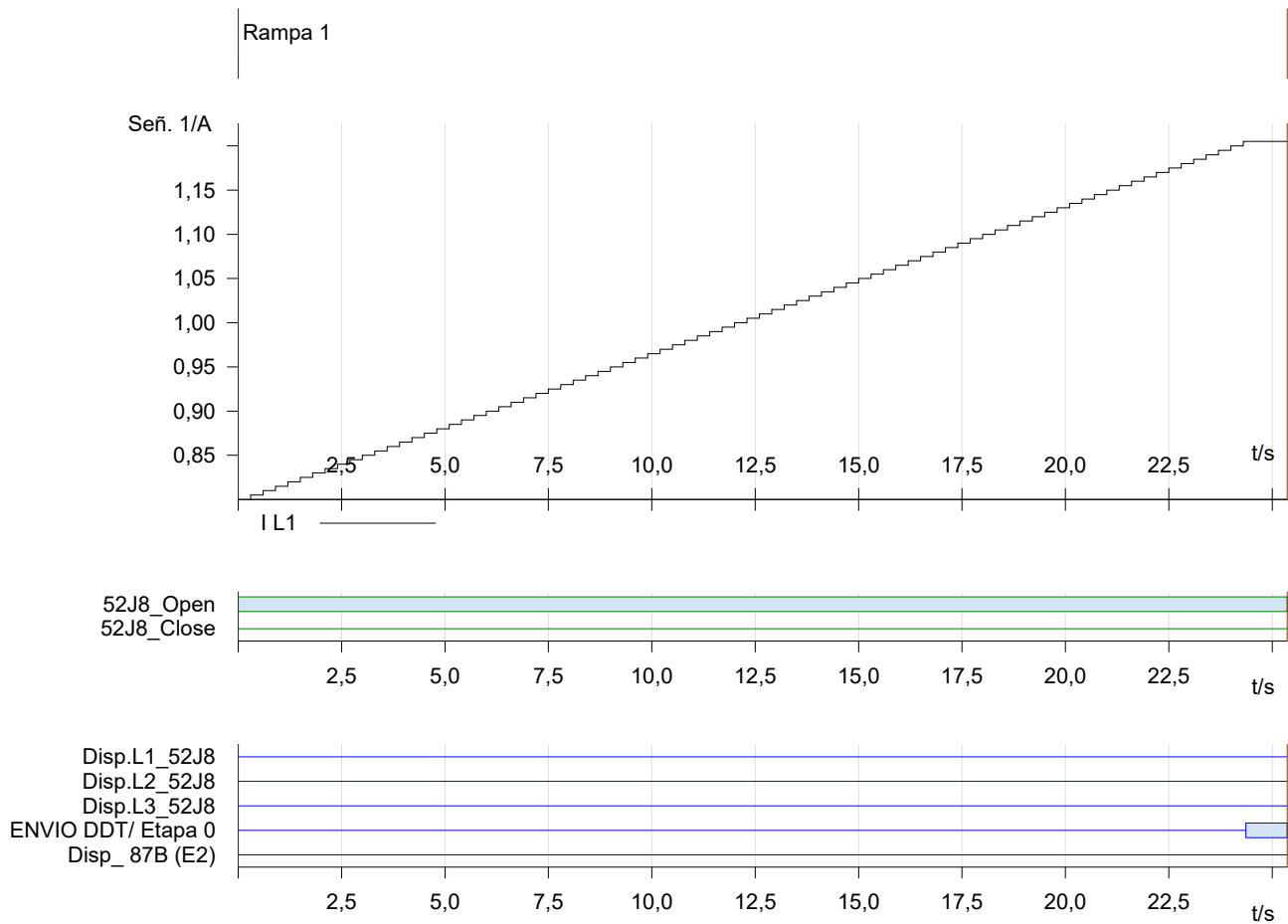
Nº de estados de rampa:	1
Pasos totales por prueba:	101
Tiempo total por prueba:	30,300 s
Nº de ejecuciones de prueba:	1
Modo de entrada:	Directo
Tipo de falta:	

Magnitudes en rampa

I L1 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	800,0 mA
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	5,000 mA
Señ. 1 d/dt	16,67 mA/s
52J8_Open	1
52J8_Close	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	101
Tiempo de rampa	30,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
Disp.L1_52J8	X
Disp.L2_52J8	X
Disp.L3_52J8	X
ENVIO DDT/ Etapa 0	1
Disp_87B (E2)	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	1,000 s



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	25,36 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	25,36 s		n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.1.2 Pickup Fase L2 End Fault:

Ajustes de la prueba

General

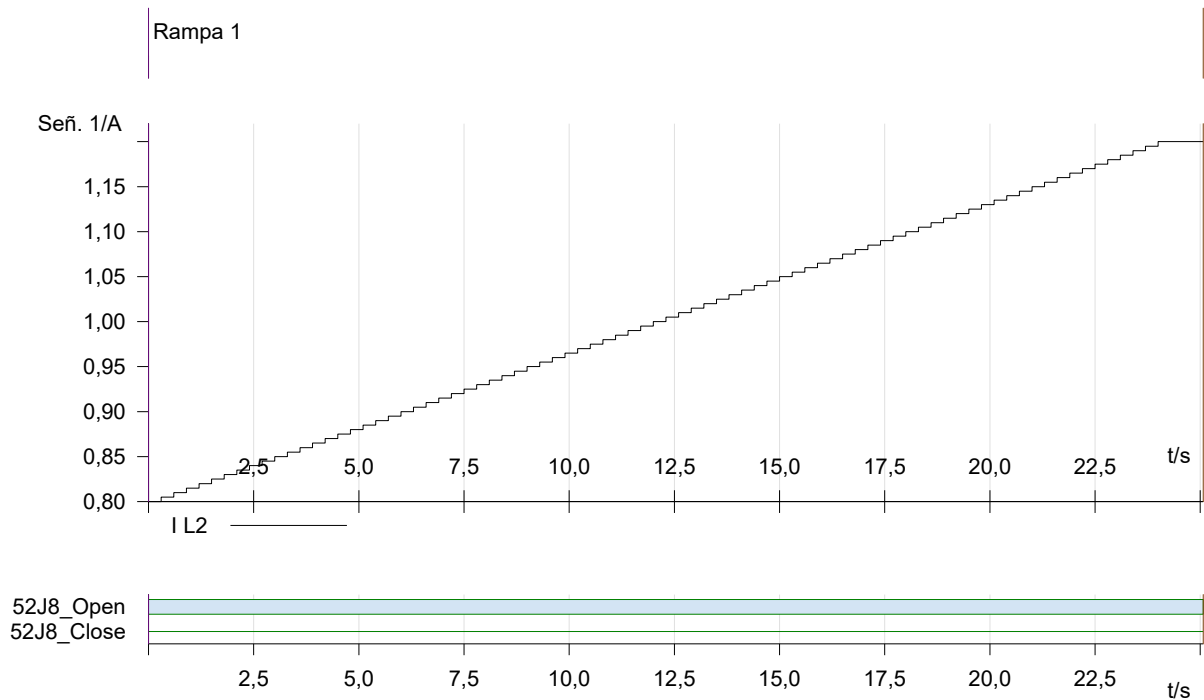
Nº de estados de rampa: 1
Pasos totales por prueba: 101
Tiempo total por prueba: 30,300 s
Nº de ejecuciones de prueba: 1
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

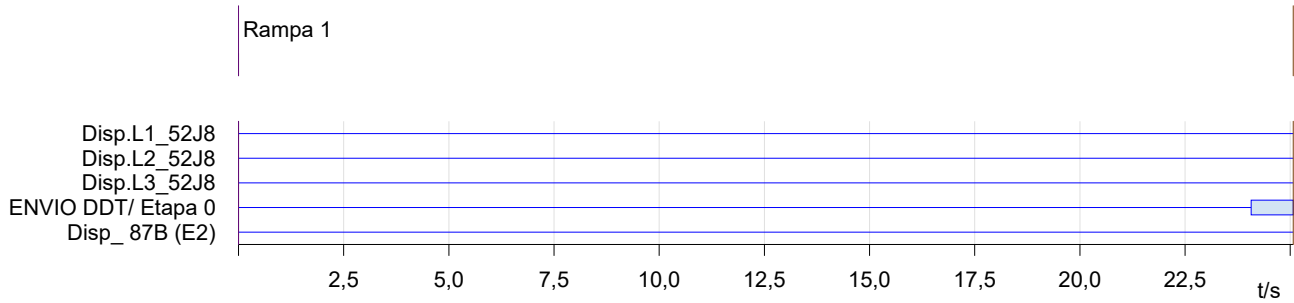
Magnitudes en rampa

I L2 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	800,0 mA
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	5,000 mA
Señ. 1 d/dt	16,67 mA/s
52J8_Open	1
52J8_Close	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	101
Tiempo de rampa	30,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	OR
Disp.L1_52J8	X
Disp.L2_52J8	X
Disp.L3_52J8	X
ENVIO DDT/ Etapa 0	1
Disp_87B (E2)	1
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	1,000 s





Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	25,07 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	25,07 s		n/a

Estado de la prueba:

Prueba correcta

11.1.3 Pickup Fase L3 End Fault:

Ajustes de la prueba

General

Nº de estados de rampa: 1
Pasos totales por prueba: 101
Tiempo total por prueba: 30,300 s
Nº de ejecuciones de prueba: 1
Modo de entrada: Directo
Tipo de falta:

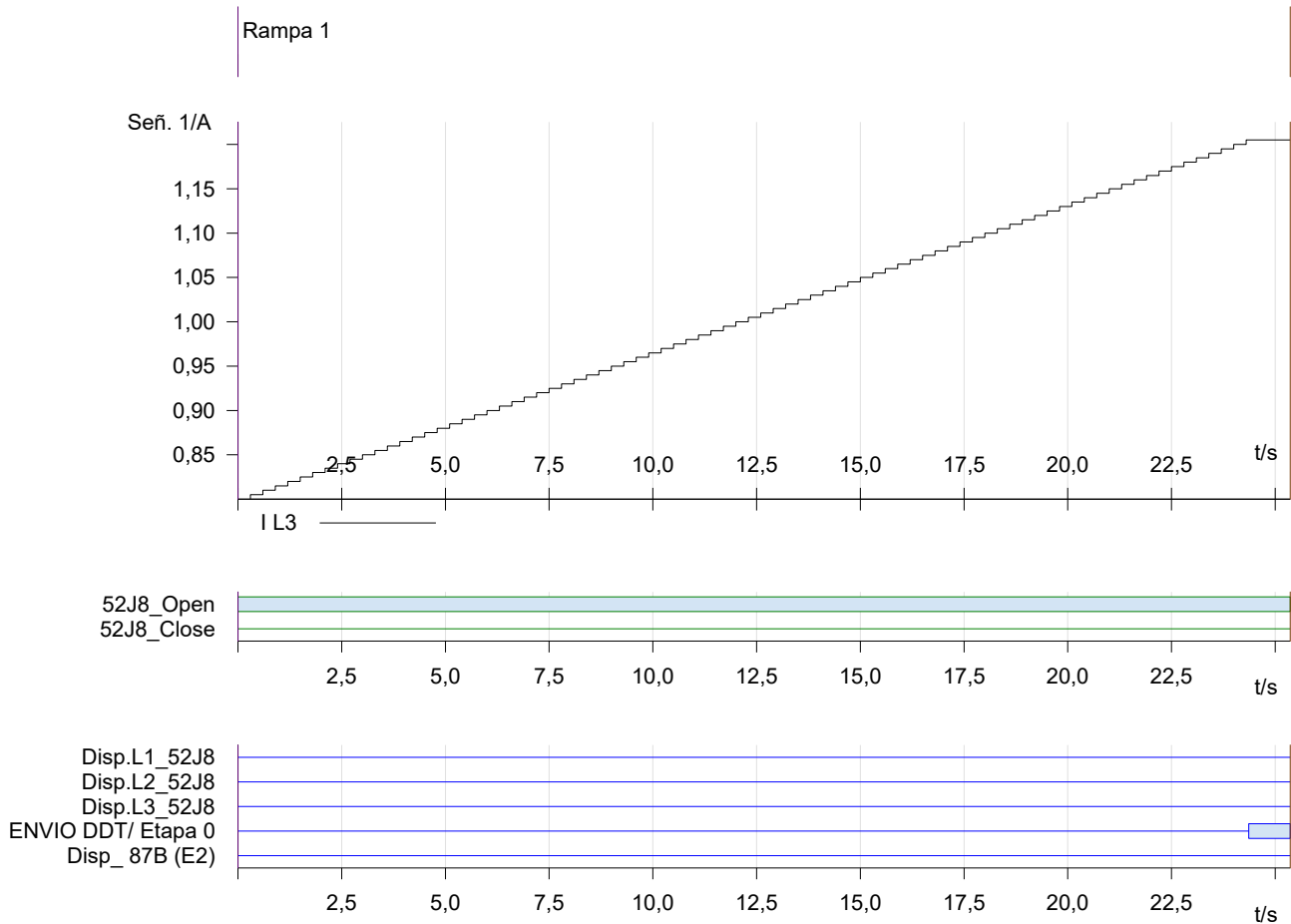
Magnitudes en rampa

I L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	800,0 mA
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	5,000 mA
Señ. 1 d/dt	16,67 mA/s
52J8_Open	1

52J8_Close	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	101
Tiempo de rampa	30,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	AND
Disp.L1_52J8	X
Disp.L2_52J8	X
Disp.L3_52J8	X
ENVIO DDT/ Etapa 0	1
Disp_87B (E2)	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	1,000 s



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	25,36 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	25,36 s		n/a

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.1.4 Pickup Fase L123 End Fault:

Ajustes de la prueba

General

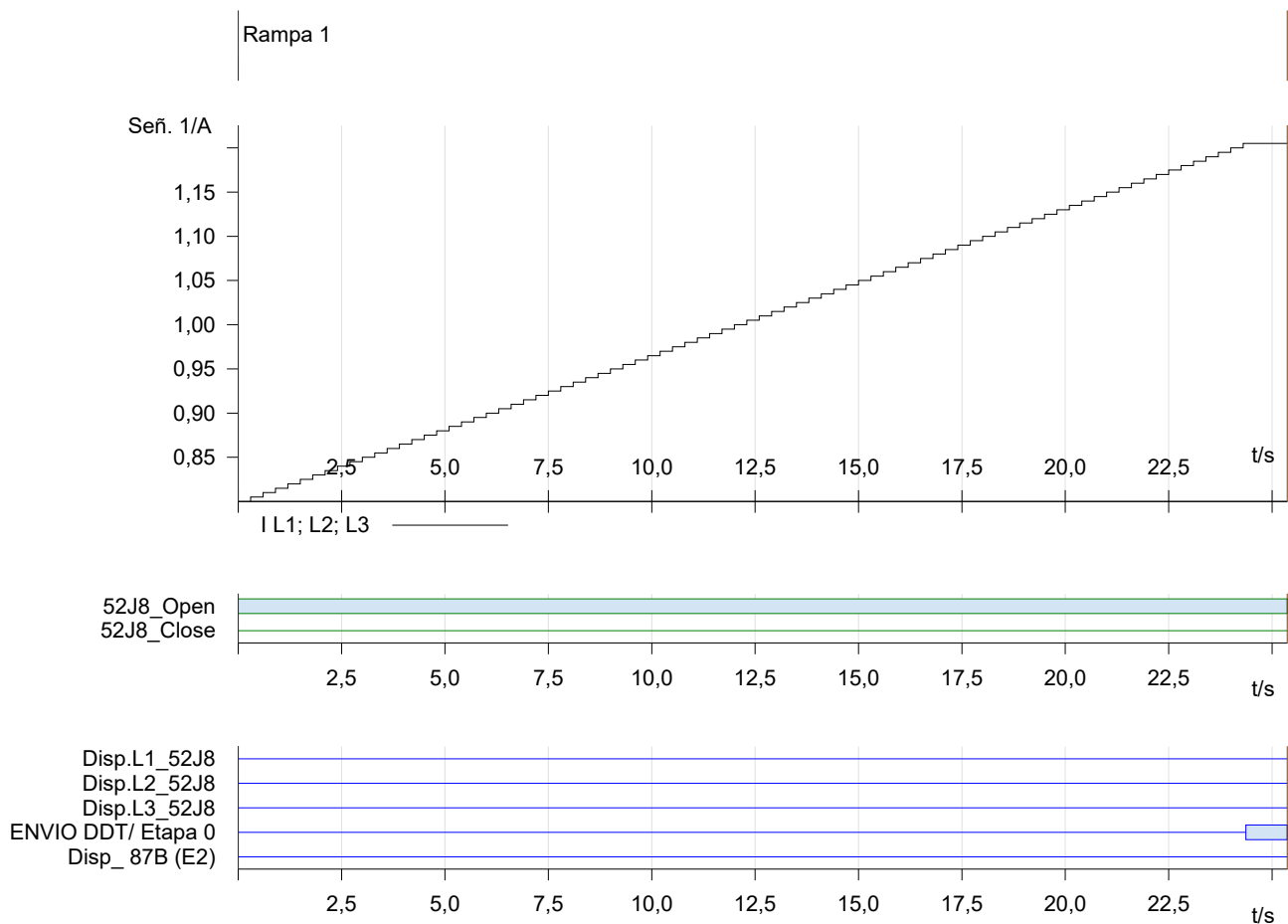
Nº de estados de rampa:	1
Pasos totales por prueba:	101
Tiempo total por prueba:	30,300 s
Nº de ejecuciones de prueba:	1
Modo de entrada:	Directo
Tipo de falta:	

Magnitudes en rampa

I L1; L2; L3 / Magnitud

Estados de rampa

Rampa	Rampa 1
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz
Forzar fases abs.	No
Señ. 1 Desde	800,0 mA
Señ. 1 Hasta	1,300 A
Señ. 1 Delta	5,000 mA
Señ. 1 d/dt	16,67 mA/s
52J8_Open	1
52J8_Close	0
dt por paso	300,0 ms
Pasos de rampa	101
Tiempo de rampa	30,300s
Trigger	Bin
Lógica del trigger	AND
Disp.L1_52J8	X
Disp.L2_52J8	X
Disp.L3_52J8	X
ENVIO DDT/ Etapa 0	1
Disp_87B (E2)	X
Paso atrás	No
Tiempo de retardo	1,000 s



Datos del cursor

	Tiempo	Señal	Valor
Cursor 1	0,000 s	<ninguno>	n/a
Cursor 2	25,37 s	<ninguno>	n/a
C2 - C1	25,37 s		n/a

**Estado de la prueba:
Prueba correcta**

----- Group end:11.1 Verificacion Pickup-----
 ----- Group:11.2 Operacion End Fault-----

11.2.1 Operacion End Fault_L1:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Falla L1+52J8 Open	Post Falla
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz

I L3	0,000 A	0,000 A	0,000 A
	120,00 °	120,00 °	120,00 °
	50,000 Hz	50,000 Hz	50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
 Comienzo: 04-abr.-2019 14:24:22
 Nombre de usuario:
 Compañía:

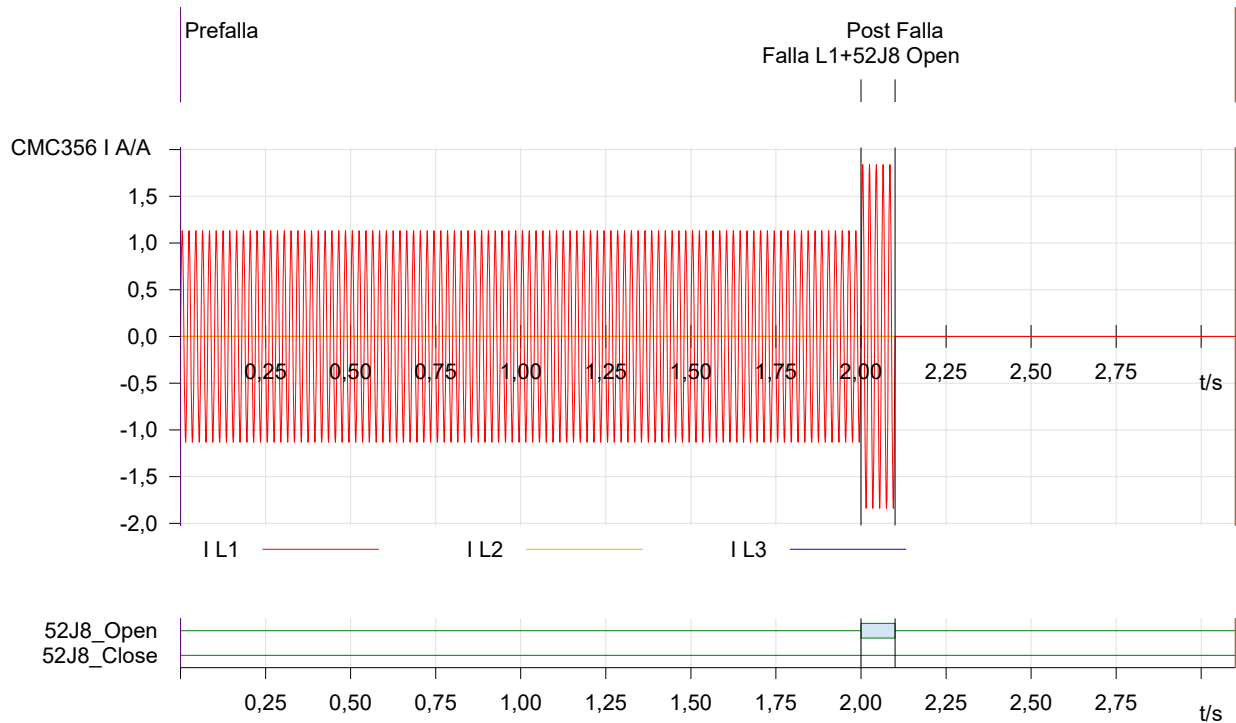
Versión: 4.00
 Fin: 04-abr.-2019 14:24:26
 Administrador:

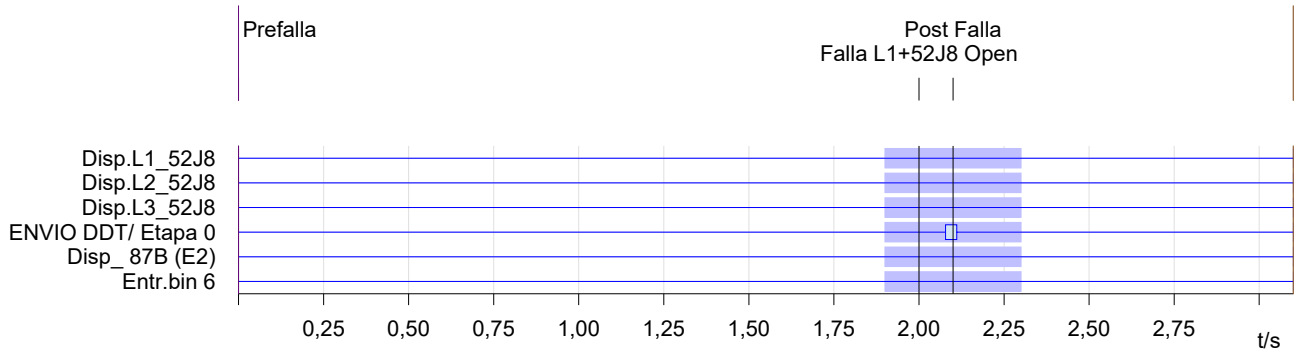
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Falla L1+52J8 Open	Post Falla
Eval.	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	100,0 ms	200,0 ms
Disp.L1_52J8	0	0	0
Disp.L2_52J8	0	0	0
Disp.L3_52J8	0	0	0
ENVIO DDT/ Etapa 0	0	0	0
Disp_87B (E2)	0	1	0
Entr.bin 6	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado





Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
2,000 s	Salida	52J8_Open	0>1
2,078 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	0>1
2,100 s	Salida	52J8_Open	1>0
2,111 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.2 Operacion End Fault_L2:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Falla L2+52J8 Open	Post Falla
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
Comienzo: 04-abr.-2019 14:25:03
Nombre de usuario:
Compañía:

Versión: 4.00
Fin: 04-abr.-2019 14:25:08
Administrador:

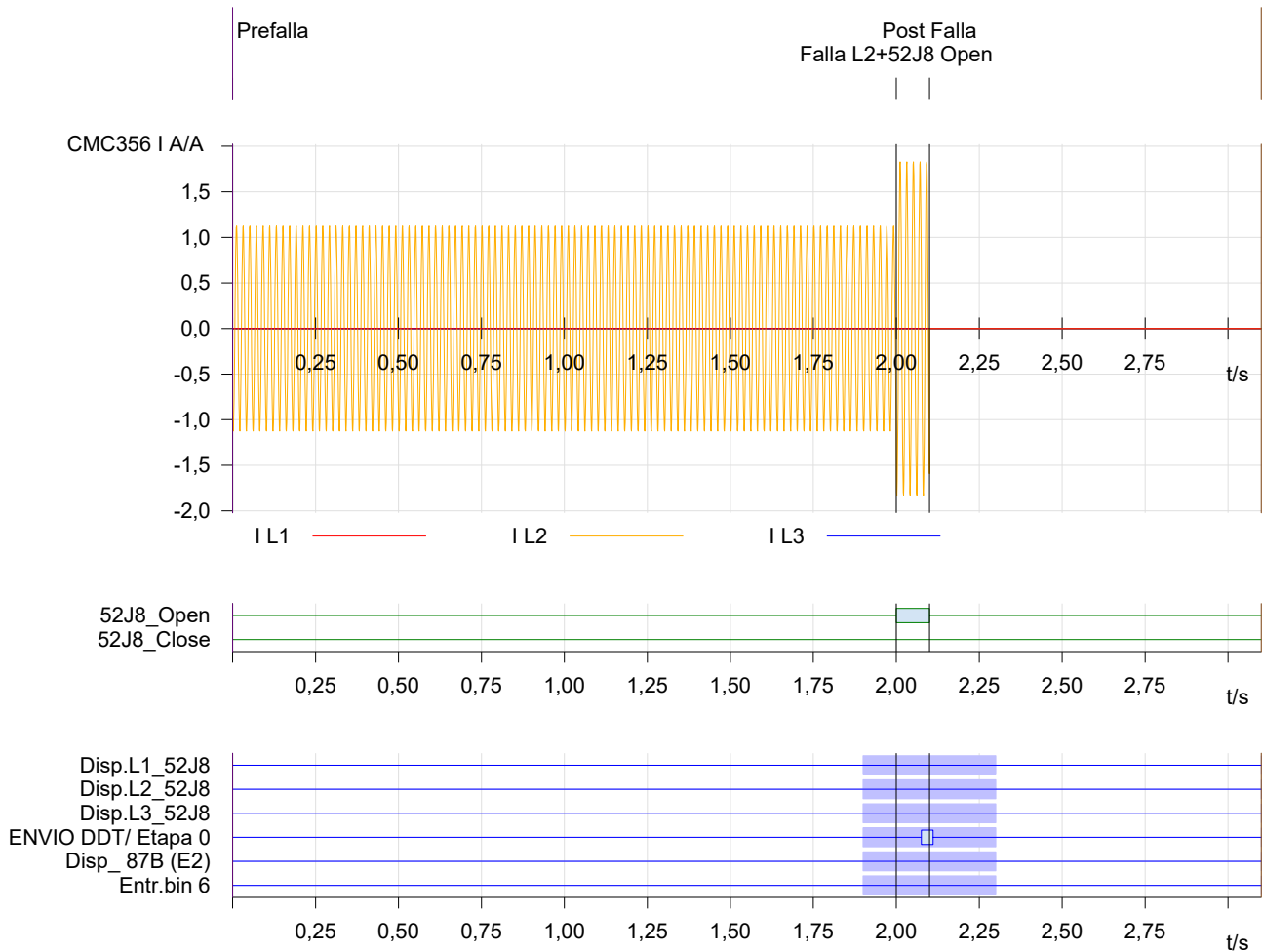
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Falla L2+52J8 Open	Post Falla
Eval.	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	100,0 ms	200,0 ms

Disp.L1_52J8	0	0	0
Disp.L2_52J8	0	0	0
Disp.L3_52J8	0	0	0
ENVIO DDT/ Etapa 0	0	0	0
Disp_87B (E2)	0	1	0
Entr.bin 6	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
2,000 s	Salida	52J8_Open	0>1
2,076 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	0>1
2,100 s	Salida	52J8_Open	1>0
2,111 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.3 Operacion End Fault_L3:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Falla L3+52J8 Open	Post Falla
I L1	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
 Comienzo: 04-abr.-2019 14:25:24
 Nombre de usuario:
 Compañía:

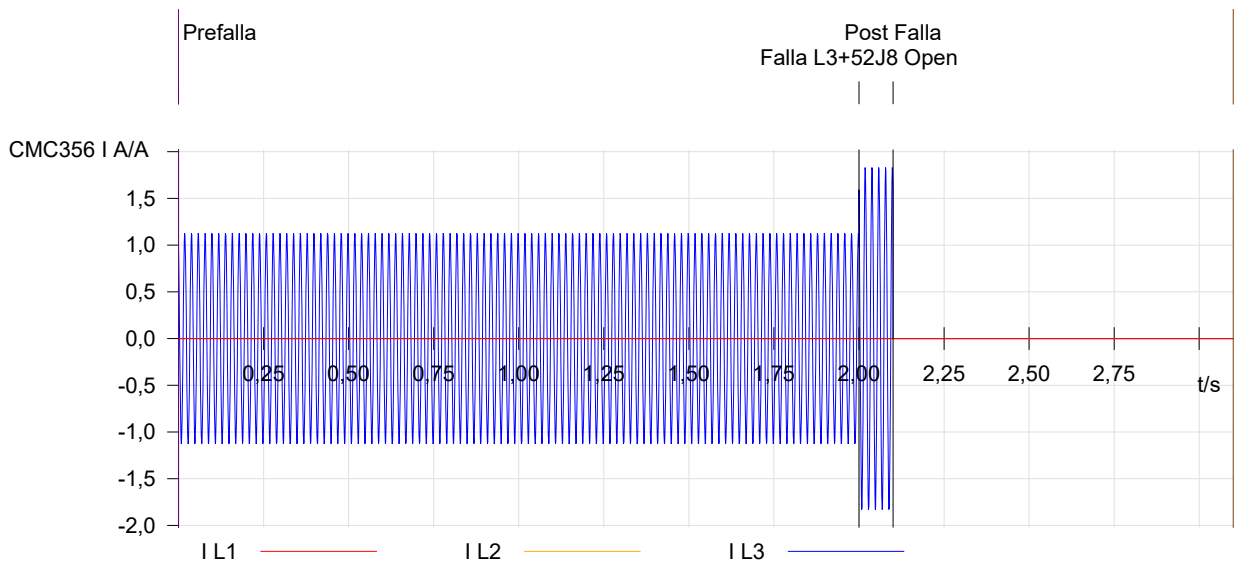
Versión: 4.00
 Fin: 04-abr.-2019 14:25:29
 Administrador:

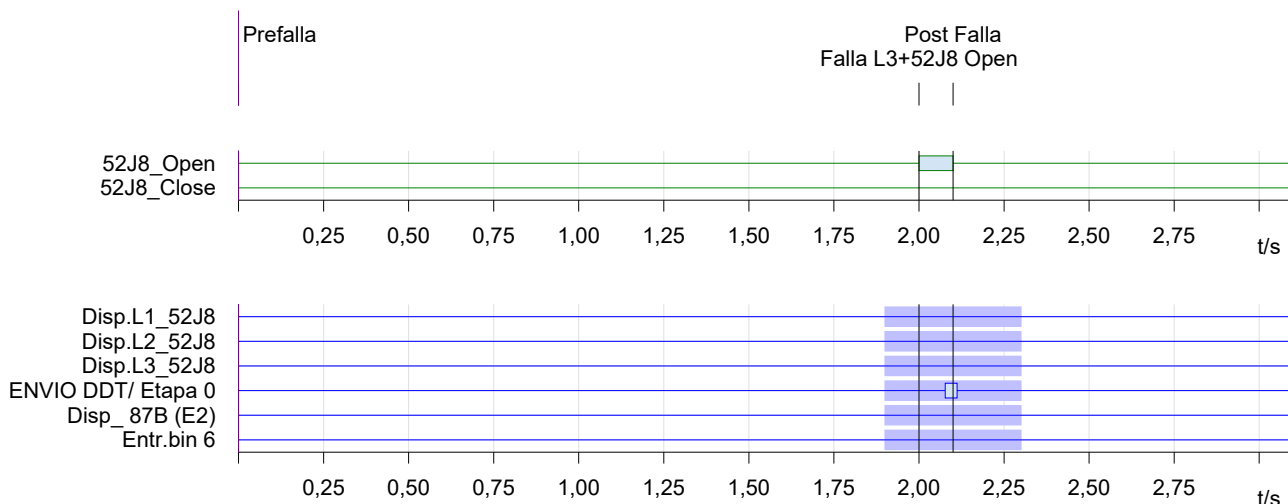
Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Falla L3+52J8 Open	Post Falla
Eval.	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	100,0 ms	200,0 ms
Disp.L1_52J8	0	0	0
Disp.L2_52J8	0	0	0
Disp.L3_52J8	0	0	0
ENVIO DDT/ Etapa 0	0	0	0
Disp_87B (E2)	0	1	0
Entr.bin 6	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado





Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
2,000 s	Salida	52J8_Open	0>1
2,077 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	0>1
2,100 s	Salida	52J8_Open	1>0
2,112 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	1>0

Estado de la prueba:

Prueba correcta

11.2.4 Operacion End Fault_L123:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Falla L123+52J 8 Open	Post Falla
	I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
 Comienzo: 04-abr.-2019 15:10:38
 Nombre de usuario:
 Compañía:

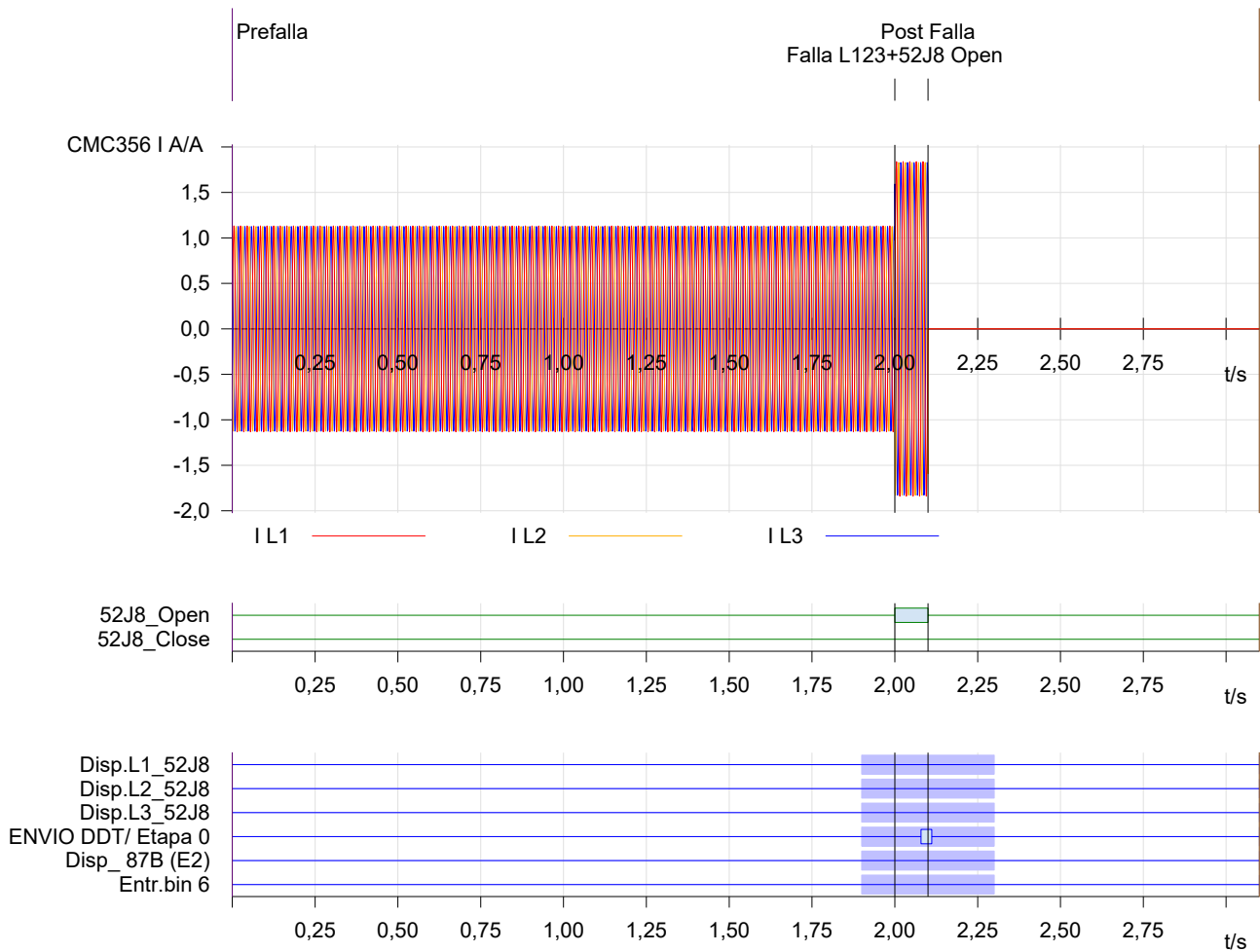
Versión: 4.00
 Fin: 04-abr.-2019 15:10:42
 Administrador:

Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Falla L123+52J 8 Open	Post Falla
Eval.	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	100,0 ms	200,0 ms
Disp.L1_52J8	0	0	0
Disp.L2_52J8	0	0	0
Disp.L3_52J8	0	0	0
ENVIO DDT/ Etapa 0	0	0	0
Disp_87B (E2)	0	1	0
Entr.bin 6	0	1	0

Eval.: +.. Correcto x.. Incorrecto o.. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
2,000 s	Salida	52J8_Open	0>1
2,079 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	0>1
2,100 s	Salida	52J8_Open	1>0
2,112 s	Entrada	ENVIO DDT/ Etapa 0	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

11.2.5 NO Operacion End Fault_L123:

Ajustes de la prueba

Estado	Prefalla	Falla L123+52J 8 Closed	Post Falla
I L1	800,0 mA 0,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 0,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 0,00 ° 50,000 Hz
I L2	800,0 mA -120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A -120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A -120,00 ° 50,000 Hz
I L3	800,0 mA 120,00 ° 50,000 Hz	1,300 A 120,00 ° 50,000 Hz	0,000 A 120,00 ° 50,000 Hz

Módulo de prueba

Nombre: OMICRON State Sequencer
Comienzo: 04-abr.-2019 15:12:04
Nombre de usuario:
Compañía:

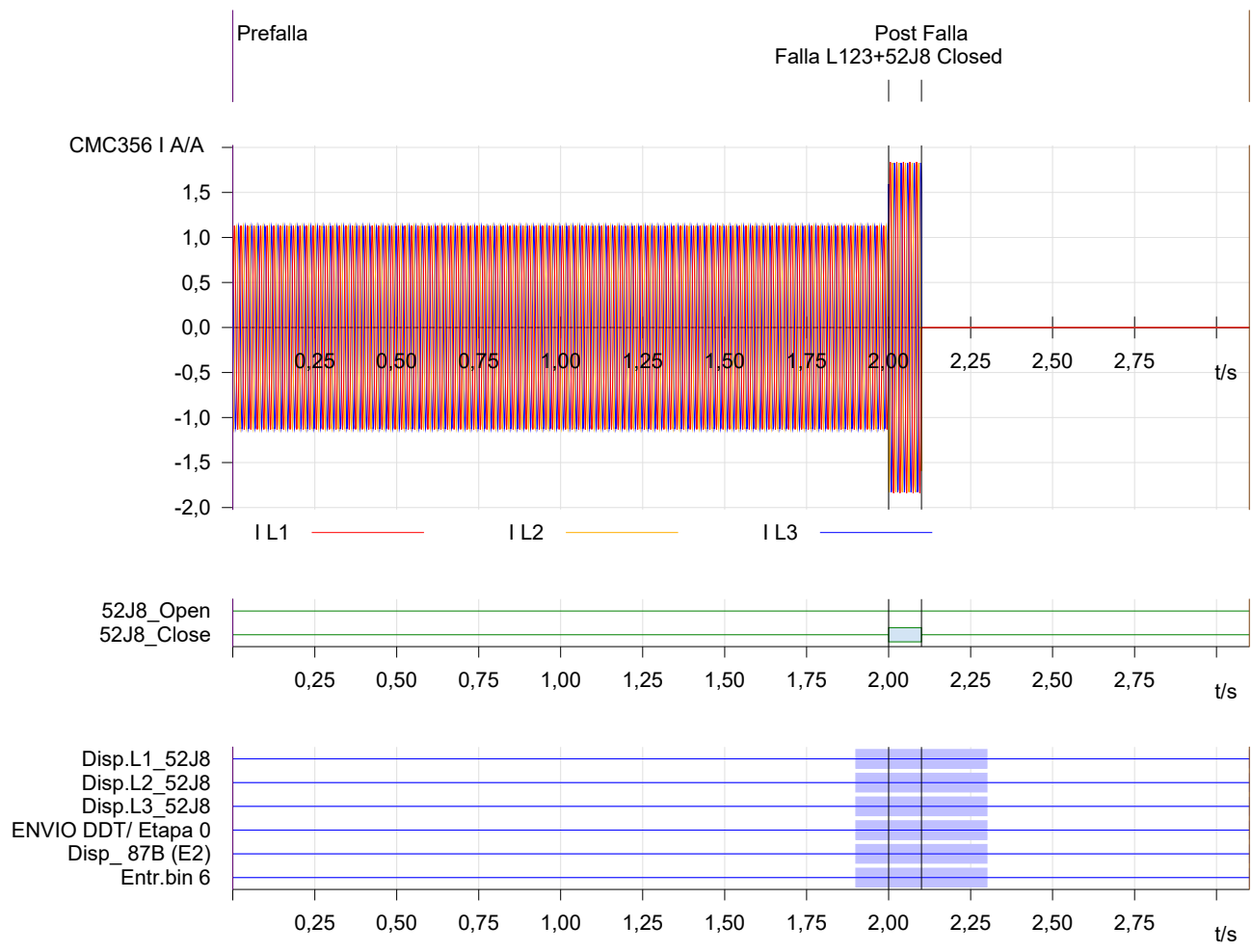
Versión: 4.00
Fin: 04-abr.-2019 15:12:09
Administrador:

Resultados de la prueba

Evaluación de estado

	Prefalla	Falla L123+52J 8 Closed	Post Falla
Eval.	+	+	+
Tolerancia	0,000 s	100,0 ms	200,0 ms
Disp.L1_52J8	0	0	0
Disp.L2_52J8	0	0	0
Disp.L3_52J8	0	0	0
ENVIO DDT/ Etapa 0	0	0	0
Disp_87B (E2)	0	1	0
Entr.bin 6	0	1	0

Eval.: + .. Correcto x .. Incorrecto o .. No evaluado



Registrador de sucesos

Tiempo	Tipo	Nombre de la señal	Pendiente
2,000 s	Salida	52J8_Close	0>1
2,100 s	Salida	52J8_Close	1>0

Estado de la prueba:
Prueba correcta

----- Group end:11.2 Operacion End Fault-----

----- Group end:11. Operacion End Fault_50BF E0-----